

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

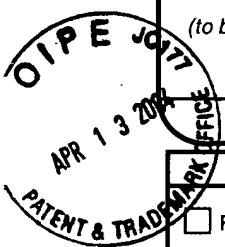
**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Please type a plus sign (+) inside this box →

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

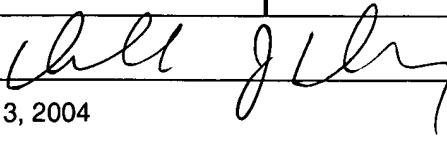
Application Number	10/773,227
Filing Date	February 9, 2004
Inventor(s)	Tomoo FURUKAWA et al.
Group Art Unit	Unknown
Examiner Name	Unknown
Attorney Docket Number	12480-000034/US



ENCLOSURES (check all that apply)

<input type="checkbox"/> Fee Transmittal Form	<input type="checkbox"/> Assignment Papers (for an Application)	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication to Group
<input type="checkbox"/> Fee Attached	<input type="checkbox"/> Letter to the Official Draftsperson and _____ Sheets of Formal Drawing(s)	<input type="checkbox"/> LETTER SUBMITTING APPEAL BRIEF AND APPEAL BRIEF (w/clean version of pending claims)
<input type="checkbox"/> Amendment	<input type="checkbox"/> Licensing-related Papers	<input type="checkbox"/> Appeal Communication to Group (Notice of Appeal, Brief, Reply Brief)
<input type="checkbox"/> After Final	<input type="checkbox"/> Petition	<input type="checkbox"/> Proprietary Information
<input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s)	<input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application	<input type="checkbox"/> Status Letter
<input type="checkbox"/> Extension of Time Request	<input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address	<input checked="" type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below): Priority Letter
<input type="checkbox"/> Express Abandonment Request	<input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer	
<input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement	<input type="checkbox"/> Request for Refund	
<input checked="" type="checkbox"/> Certified Copies of Priority Documents	<input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s) _____	
<input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/ Incomplete Application		Remarks
<input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53		

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual name	Harness, Dickey & Pierce, P.L.C.	Attorney Name Donald J. Daley	Reg. No. 34,313
Signature			
Date	April 13, 2004		



PATENT
12480-000034/US

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Tomoo FURUKAWA et al. Conf. No.: Unknown
Filing Date: February 9, 2004 Examiner: Unknown
Application No.: 10/773,227 Group Art Unit: Unknown
Title: EVALUATION APPARATUS OF LIQUID CRYSTAL
DISPLAY DEVICE, LIQUID CRYSTAL DISPLAY
DEVICE, AND EVALUATION METHOD OF
LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PRIORITY LETTER

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

April 13, 2004

Dear Sirs:

Pursuant to the provisions of 35 U.S.C. 119, enclosed are certified copies of the following priority documents:

<u>Application No.</u>	<u>Date Filed</u>	<u>Country</u>
2003-032893	02/10/2003	JAPAN
2004-004793	01/09/2004	JAPAN

In support of Applicants' priority claim, please enter these documents into the file.

Respectfully submitted,

HARNESS, DICKEY, & PIERCE, P.L.C.

By Donald J. Daley
Donald J. Daley, Reg. No. 34,313

P.O. Box 8910
Reston, Virginia 20195
(703) 668-8000

DJD/bof

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 2月10日
Date of Application:

出願番号 特願2003-032893
Application Number:

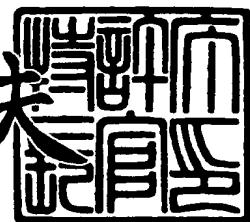
[ST. 10/C] : [JP2003-032893]

出願人 シャープ株式会社
Applicant(s):

2004年 3月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 02J04914

【提出日】 平成15年 2月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G09G 3/20 632

G09G 3/20 641

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

【氏名】 古川 智朗

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

【氏名】 塩見 誠

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

【氏名】 繁田 光浩

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080034

【弁理士】

【氏名又は名称】 原 謙三

【電話番号】 06-6351-4384

【選任した代理人】

【識別番号】 100113701

【弁理士】

【氏名又は名称】 木島 隆一

【選任した代理人】

【識別番号】 100116241

【弁理士】

【氏名又は名称】 金子 一郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003229

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置の評価装置および液晶表示装置ならびに液晶表示装置の評価方法

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

評価対象の液晶パネルに映像信号を与える映像信号発生回路と、前記液晶パネルの表示部に臨む光学受光素子と、前記光学受光素子からの出力が入力される波形解析装置とを含み、

前記映像信号発生回路は、階調を変化させる前の階調をAとし、到達させるべき階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをC（ただし、C=Bを含む）とするとき、オーバーシュートレベルCを掃引させつつ、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネルに与え、

前記波形解析装置は、前記オーバーシュートレベルCを掃引させた応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も早く到達したレベルを、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆくことを特徴とする液晶表示装置の評価装置。

【請求項 2】

前記オーバーシュート駆動はnフィールド期間に亘って行われ、

前記映像信号発生回路は、nフィールド期間に亘るオーバーシュート信号のレベルを、順にC1, C2, …, Cn（nは1以上の任意の整数）とするとき、オーバーシュートレベルC1～Cnをそれぞれ掃引させつつ、A→C1～Cn→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネルに与え、

前記波形解析装置は、前記オーバーシュートレベルC1～Cnを掃引させた応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も早く到達したレベルを、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆくことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項 3】

少なくとも前記液晶パネルを収納することができる恒温槽をさらに備えることを特徴とする請求項1または2記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項4】

前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルCのそれぞれに対応して設けられるスイッチを備え、該スイッチをデジタル的にオン／オフ制御することで、スイッチング態様に対応した電圧を前記映像信号として順次出力することを特徴とする請求項1または3記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項5】

前記オーバーシュートレベルCを調整するスイッチは、粗調整用と微調整用との2種類のスイッチで構成されていることを特徴とする請求項4記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項6】

前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルC₁～C_nのそれぞれに対応して設けられるスイッチを備え、該スイッチをデジタル的にオン／オフ制御することで、スイッチング態様に対応した電圧を前記映像信号として順次出力することを特徴とする請求項2または3記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項7】

前記オーバーシュートレベルC₁～C_nを調整するスイッチは、粗調整用と微調整用との2種類で構成されていることを特徴とする請求項6記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項8】

A < Bであるライズ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、C₁～C_nを、

$$B \leqq C_1 \geqq C_2 \geqq \dots \geqq C_n$$

であり、かつ、任意のk番目（1 ≤ k ≤ nの整数）のオーバーシュートレベルC_kを、該オーバーシュートレベルC_kによる応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該オーバーシュートレベルC_kによる応答波形が到達階調Bのレベルにほぼ等しくなっていれば、

$$C_k + 1 \sim C_n = B$$

と決定することを特徴とする請求項2、3、6、7の何れか1項に記載の液晶表

示装置の評価装置。

【請求項 9】

$A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A、B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を

$$B \geq C_1 \leq C_2 \leq \cdots \leq C_n$$

であり、かつ、任意の k 番目 ($1 \leq k \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_k を、該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、

$$C_{k+1} \sim C_n = B$$

と決定することを特徴とする請求項 2、3、6、7 の何れか 1 項に記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項 10】

$A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調 A、B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、

$$A < C_1 \leq \cdots \leq C_k < B \leq C_{k+1} \geq \cdots \geq C_n \quad (k \text{ は } 1 \leq k \leq n \text{ の整数})$$

であり、かつ、任意の j 番目 ($k+1 \leq j \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_j を、該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、

$$C_{j+1} \sim C_n = B$$

と決定することを特徴とする請求項 2、3、6、7 の何れか 1 項に記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項 11】

$A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A、B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を

$$A > C_1 \geq \cdots \geq C_k > B \geq C_{k+1} \leq \cdots \leq C_n \quad (k \text{ は } 1 \leq k \leq n \text{ の整数})$$

であり、かつ、任意の j 番目 ($k+1 \leq j \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_j を、該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_j に

よる応答波形が到達階調Bのレベルにほぼ等しくなっていれば、

$$C_j + 1 \sim C_n = B$$

と決定することを特徴とする請求項2, 3, 6, 7の何れか1項に記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項12】

$A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、 $C_1 \sim C_n$ を、

$$B \leq C_1 = C_2 = \cdots = C_n$$

であり、かつ、任意のk番目（ $1 \leq k \leq n$ の整数）のオーバーシュートレベル C_k を、総てのオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最大値に決定することを特徴とする請求項2, 3, 6, 7の何れか1項に記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項13】

$A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、 $C_1 \sim C_n$ を

$$B \geq C_1 = C_2 = \cdots = C_n$$

であり、かつ、任意のk番目（ $1 \leq k \leq n$ の整数）のオーバーシュートレベル C_k を、総てのオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最小値に決定することを特徴とする請求項2, 3, 6, 7の何れか1項に記載の液晶表示装置の評価装置。

【請求項14】

前記請求項1, 4, 5の何れか1項に記載の評価装置によって決定されたオーバーシュートレベル C を、駆動回路がオーバーシュート駆動用のルックアップテーブルとしてストアしていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項15】

前記請求項2, 3, 6～13の何れか1項に記載の評価装置によって決定されたオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ を、駆動回路がオーバーシュート駆動用のルックアップテーブルとしてストアしていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項16】

評価対象の液晶パネルにオーバーシュート信号を与え、その応答結果から、最

適オーバーシュート信号レベルを評価する方法であって、

階調を変化させる前の階調をAとし、到達させるべき階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをC（ただし、C=Bを含む）とするとき、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を前記液晶パネルに与え、表示させるステップと

、
前記映像信号による液晶パネルの表示画像を読取るステップと、

読取った表示画像の波形解析を行うステップとを、前記オーバーシュートレベルCを掃引させつつ、繰返し行い、

各オーバーシュートレベルCでの応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も早く到達したレベルを、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆくステップとを含むことを特徴とする液晶表示装置の評価方法。

【請求項 17】

前記オーバーシュート駆動はnフィールド期間に亘って行われ、
映像信号発生回路は、nフィールド期間に亘るオーバーシュート信号のレベルを、順にC1, C2, …, Cn（nは1以上の任意の整数）とするとき、オーバーシュートレベルC1～Cnをそれぞれ掃引させつつ、A→C1～Cn→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネルに与えることを特徴とする請求項16記載の液晶表示装置の評価方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置の評価装置およびその評価によって得られたオーバーシュートパラメータを用いる駆動回路を搭載する液晶表示装置ならびに液晶表示装置の評価方法に関し、特に前記評価としては、応答性の評価に好適に実施されるものに関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、フラットパネルディスプレイ（F P D）の進歩は目覚しく、ブラウン管モニタが様々なF P Dに置換えられつつある。特に、F P Dの先駆け的な存在で

ある液晶ディスプレイ（Liquid Crystal Display：LCD）は、技術進歩が目覚しく、日常生活の様々な場面で利用されるようになり、その発展には、より一層の期待が高まっている。

【0003】

しかしながら、LCDには、未だ大きな弱点がいくつか残されている。その代表的なものの1つは、動画表示が苦手であると言うことである。この主原因の1つとして挙げられるのは、液晶の応答速度が遅いということである。液晶の応答速度というと、白黒のスイッチング速度で考えることが多いが、前記のようなブラウン管モニタの置換えに伴い、中間調－中間調でのスイッチングが大きな割合を占めており、この状態での液晶の応答速度を考慮しなければならない。しかも、一般的には、応答速度は白黒スイッチングよりも中間調－中間調でのスイッチングの方が遅く、問題となっている。

【0004】

このため、応答速度の高速化は、テレビをブラウン管からLCDに置換える際に避けて通れない問題であり、あらゆる階調間での液晶の応答を、如何にして高速化するかということが大きな課題となっている。上記課題の解決手段の1つとして提唱されているのが、オーバーシュート（Over shoot：OS）駆動法である。この駆動方法の例を図11に示す。液晶が、ある階調レベルAから別の階調レベルBにスイッチングする時、一般にはAとBとの階調レベル差が大きい程、液晶は高速スイッチングをする。

【0005】

したがって、図11のようにA<Bのライズ応答であれば、B<Cとなる階調レベルのOS階調Cを一瞬入力した後に、目標とする階調レベルBを入力することで、通常のAからBへのスイッチング速度よりもより高速に液晶をスイッチングさせることが可能になる。また、A>Bのディケイ応答であれば、B>Cとなる階調レベルのOS階調Cを入力した後に、目標とする階調レベルBを入力することで、通常のAからBへのスイッチング速度よりもより高速に液晶をスイッチングさせることが可能になる。

【0006】

実際には、フル階調スイッチング（たとえば、0階調から255階調へのスイッチング）時に、液晶は最も高速にスイッチングするので、OS駆動法による液晶の応答速度は、理論上、あらゆる階調間のスイッチングにおいて、フル階調スイッチングの応答速度まで高速化が可能になる。したがって、フル階調スイッチングが充分に高速応答をする液晶表示モードにおいて、OS駆動法を用いることによって、あらゆる階調間のスイッチングにおいて充分な高速応答が可能なLCDを得ることが可能である。

【0007】

そして、このようなOS駆動法を実用化するに際して、最も注意を払う必要のある点の1つが、OSパラメータ（実際の駆動時にOS階調Cとして印可する信号レベル）を如何にして決定するかということである。OS駆動を行うための回路において、一般的に用いられているアルゴリズムの要点は、「任意のnフィールドの階調（現在の階調A）と（n+1）フィールドの階調（到達階調B）とを比較し、ルックアップテーブル（Look Up Table: LUT）を参照して、OSパラメータCを決定する」ということである。LUTは、たとえば、「nフィールドが120階調、（n+1）フィールドが150階調に対し、OSパラメータCは190階調」といったように、AとBとの値の組合せでCを決定している一覧表である。このLUTを正確に決定できないと、以下のような状態になり、ディスプレイとしてきちんとした表示が得られない。

【0008】

すなわち、適切なOSパラメータCを設定した場合、図12に示すように、1フィールド期間内で、到達階調Bを行き過ぎることなく、該到達階調Bに達している理想的な応答性を得ることができる。これに対して、充分な高速応答を得るために、あまりに大きなOSパラメータCを設定した場合、図13に示すように、液晶の応答波形に角が現れる。このような場合、液晶が要求されるスイッチングレベルよりも過剰に応答していることになる。この状態で実際にLCDを見た場合は、スイッチング時や動画表示の際に不自然に光って見える。また、液晶の過剰応答を恐れて充分な大きさのOSパラメータCに設定しない場合、図14に示すように、充分な応答性が得られず（1フィールド期間内で到達階調Bに達し

ていない）、OSパラメータCのレベルが小さくなる程、図15で示すOS駆動を行わない場合の応答性に近付き、OS駆動の意味を失ってしまう。

【0009】

そこで、OSパラメータCの決定は、典型的な従来技術では、特開平11-352450号公報で示されるように、液晶のスイッチング時に起こるセルの容量変化を求め、そこから該OSパラメータCを計算することで行われている。

【0010】

また、以下のように、通常駆動の応答波形から、OSパラメータCを見積もある手法も考案されている。

1. 通常駆動法においての各階調間の応答波形を測定する。
2. その波形から、OS信号印加分に相当する時間の経過後に到達する階調レベルを求める。
3. その結果から、各階調間のスイッチングに必要なOSパラメータCを見積もり、LUTを作成する。

【0011】

【特許文献1】

特開平11-352450号公報（公開日：平成11年12月24日）

【0012】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記容量変化からOSパラメータCを計算する場合、液晶の粘性の応答への影響をまったく考慮していないので、計算結果と実際に必要なOSパラメータCとに大きな誤差が生じることが多い。すなわち、本来であれば、セル厚、セルの形状、使用する液晶材料等によって、OS量が一意的に決まらなければならぬところ、実際には、場所によって30%以上の大きな誤差を発生している。一方、これまでにはパラメータの誤差に対するユーザの許容レベルが緩く、応答の遅い液晶をとにかく動画表示に耐えうるだけ高速化できていれば、ある程度のパラメータ誤差があっても許容されていたけれども、高速応答だけではなく、より精細な画質も要求される今後は、パラメータ誤差の許容範囲は極めて厳しくなり、従来法では誤差の少ないOSパラメータCを求めるのは困難である。

【0013】

また、応答波形から見積もる方法は、必要な条件を総て含んでいるけれども、正確なOSパラメータCを確定させるには、作成されたLUTを用いてOS駆動を行い、波形確認を行わなければならず、手間がかかるという問題がある。また、波形確認の結果、調整が必要である場合、正確なOSパラメータCが決定するまで、上記見積もり、確認測定を多数回繰返す必要があり、膨大な手間がかかっていた。

【0014】

本発明の目的は、最適なオーバーシュートパラメータを、容易、かつ高精度に求めることができる液晶表示装置の評価装置および液晶表示装置ならびに液晶表示装置の評価方法を提供することである。

【0015】

【課題を解決するための手段】

本発明の液晶表示装置の評価装置は、評価対象の液晶パネルに映像信号を与える映像信号発生回路と、前記液晶パネルの表示部に臨む光学受光素子と、前記光学受光素子からの出力が入力される波形解析装置とを含み、前記映像信号発生回路は、階調を変化させる前の階調をAとし、到達させるべき階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをC（ただし、C=Bを含む）とするとき、オーバーシュートレベルCを掃引させつつ、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネルに与え、前記波形解析装置は、前記オーバーシュートレベルCを掃引させた応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も早く到達したレベルを、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆくことを特徴とする。

【0016】

上記の構成によれば、液晶の応答性を向上するためのオーバーシュート駆動を行うにあたり、液晶パネルの応答性を評価し、最適オーバーシュートパラメータ（実際のオーバーシュート駆動レベル）を決定するにあたって、先ず、階調を変化させる前の任意の階調をAとし、到達させるべき任意の階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをCとするとき、オーバーシュートレベルCを掃引させ

つつ、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次出力することができる映像信号発生回路を設ける。

【0017】

次に、それぞれの映像信号による液晶パネルの表示画像を光学受光素子で光電変換し、前記波形解析装置に取込む。続いて、波形解析装置は、掃引された種々のオーバーシュートレベルCの映像信号による液晶パネルの表示結果の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も早く到達したレベルを、前記最適オーバーシュートパラメータとして、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆく。

【0018】

具体的には、たとえばライズ応答の場合、A < Bである任意の階調A、Bに対し、Cのレベルは、前記到達階調レベルB以上であり、Cを変化させて応答波形を観察し、応答波形がBのレベルに対し過剰応答しない最大のCを探すことでき、正確なオーバーシュートパラメータを決定する。すなわち、そのCのレベルでオーバーシュート駆動すれば、映像の破綻が生じず、かつオーバーシュート駆動期間内で所望とする到達階調Bに最も近いレベルの階調表示を実現することができるようになる。また、ディケイ応答の場合、A > Bである任意の階調A、Bに対し、Cのレベルは、前記到達階調レベルB以下であり、Cを変化させて応答波形を観察し、応答波形がBのレベルに対し過剰応答しない最小のCを探すことでき、正確なオーバーシュートパラメータを決定する。

【0019】

したがって、その液晶パネルのオーバーシュート駆動用の駆動回路に、前記変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けた最適オーバーシュートパラメータのルックアップテーブル（Look Up Table：LUT）をセットしておくことで、該駆動回路は、入力された映像信号の変化前の階調Aおよび到達階調Bから、前記LUTを参照して、最適オーバーシュートパラメータを決定し、液晶パネルを適切にオーバーシュート駆動することができる。

【0020】

このようにして、最適なオーバーシュートパラメータを、容易、かつ高精度に

求めることができる。また、オーバーシュート駆動を行っていない液晶パネルに対しても、オーバーシュート信号を用いた測定が可能になり、後に該パネルに対してオーバーシュート駆動を導入するようになった場合、回路設計とオーバーシュートパラメータの決定との2つの作業が必要になるけども、本発明では、回路が出来上がっていない場合でも、すなわちオーバーシュート駆動ができない状態でも、オーバーシュート駆動用のパラメータを求めることができる。

【0021】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置では、前記オーバーシュート駆動は n フィールド期間に亘って行われ、前記映像信号発生回路は、 n フィールド期間に亘るオーバーシュート信号のレベルを、順に C_1, C_2, \dots, C_n (n は 1 以上の任意の整数) とするとき、オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ をそれぞれ掃引させつつ、 $A \rightarrow C_1 \sim C_n \rightarrow B$ の順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネルに与え、前記波形解析装置は、前記オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ を掃引させた応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調 B に最も早く到達したレベルを、変化前の階調 A および到達階調 B に対応付けてストアしてゆくことを特徴とする。

【0022】

上記の構成によれば、オーバーシュート信号は、その印加期間中一定である必要はなく、たとえば低温において著しく液晶の応答が遅くなってしまう場合や、倍速駆動等において、多フィールドに亘るオーバーシュート駆動が考えられ、フィールド毎に異なったオーバーシュート信号を印加することで、その応用範囲を広げることができる。そこで、前記オーバーシュート信号のレベルを、順に C_1, C_2, \dots, C_n (n は 1 以上の任意の整数) として、前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調 A および到達階調 B を合わせて、 $(n + 2)$ 種類の信号を、それぞれ特定の時間だけこの順に出力する。

【0023】

このように、様々な n (多) フィールドオーバーシュート駆動信号を発生することで、前記多フィールドに亘るオーバーシュート駆動に対応したオーバーシュートパラメータを、正確かつ簡便に決定することができる。

【0024】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、少なくとも前記液晶パネルを収納することができる恒温槽をさらに備えることを特徴とする。

【0025】

上記の構成によれば、恒温槽を設け、その恒温槽内に液晶パネルとともに光学受光素子を設置し、または恒温槽内に液晶パネルを設置するとともに該恒温槽に前記液晶パネルの表示部を外部から観察可能なように窓を設け、その窓に前記光学受光素子を設けるなどして、前記表示結果を観察する。

【0026】

したがって、液晶パネルの評価を一定の温度条件で行うことができる。また、液晶パネルを種々の環境温度で評価することができ、それぞれの温度に最適なオーバーシュートパラメータを求めるともできる。さらに、恒温槽に窓を設けた場合、評価時の異常を速やかに発見でき、対策を講じ易くなる。

【0027】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置では、前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルCのそれぞれに対応して設けられるスイッチを備え、該スイッチをデジタル的にオン／オフ制御することで、スイッチング態様に対応した電圧を前記映像信号として順次出力することを特徴とする。

【0028】

上記の構成によれば、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルCのそれぞれを、スイッチの設定によって、任意かつ独立にデジタル的に調整することができる。前記スイッチは、多ビットスイッチが望ましく、この場合、任意階調間のスイッチングにおいて、オーバーシュートパラメータを詳細に設定することができる。

【0029】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置では、前記オーバーシュートレベルCを調整するスイッチは、粗調整用と微調整用との2種類のスイッチで構成されていることを特徴とする。

【0030】

上記の構成によれば、粗調整用スイッチでオーバーシュートレベルCのレベルをある程度調整した後、微調整用スイッチで該オーバーシュートレベルCを詳細に決定する。たとえば、前記オーバーシュートレベルCのレベルは256通りあり、これを1階調毎に変化させての測定は時間がかかる。そこで、粗調整用スイッチと微調整用スイッチとを設け、まず粗調整用スイッチで大雑把にオーバーシュートパラメータを確定し、その後微調整用スイッチで調整して正確なオーバーシュートパラメータを求めることで、短時間で正確な評価が可能となる。

【0031】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置では、前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルC₁～C_nのそれぞれに対応して設けられるスイッチを備え、該スイッチをデジタル的にオン／オフ制御することで、スイッチング態様に対応した電圧を前記映像信号として順次出力することを特徴とする。

【0032】

上記の構成によれば、前記変化前の階調A、到達階調Bおよびn（多）フィールドオーバーシュートレベルC₁～C_nのそれぞれを、スイッチの設定によって、任意かつ独立にデジタル的に調整することができる。前記スイッチは、多ビットスイッチが望ましく、この場合、任意階調間のスイッチングにおいて、オーバーシュートレベルC₁～C_nを詳細に設定することが可能である。

【0033】

たとえば、全階調で256階調の場合、前記変化前の階調Aおよび到達階調Bは、最低でも16階調毎に、好ましくは1階調毎に切換えられることが望ましい。一方、オーバーシュートレベルC₁～C_nは、1階調の変化でオーバーシュート効果が違ってくるので、1階調毎の切換えが絶対に必要である。

【0034】

したがって、前記変化前の階調Aおよび到達階調Bと、オーバーシュートレベルC₁～C_nとを独立のスイッチによって調整可能とすることで、前記階調A、Bに対するスイッチ数をむやみに増加することなく、必要なオーバーシュートパ

ラメータを、簡便かつ詳細に設定することが可能になる。

【0035】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置では、前記オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ を調整するスイッチは、粗調整用と微調整用との2種類で構成されていることを特徴とする。

【0036】

上記の構成によれば、たとえば全階調で 256 階調の場合、前記変化前の階調 A および到達階調 B は、最低でも 16 階調毎に、好ましくは 1 階調毎に切換えられ、これに対して前記オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ は、1 階調毎に切換えられる必要があるので、合計で $256 \times n$ 通となり、これを 1 階調毎に変化させての評価は時間がかかる。そこで、各オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ 毎に、粗調整用スイッチで該オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ をそれぞれある程度調整した後、微調整用スイッチで該オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ を詳細に決定する。これによって、短時間で正確な評価が可能となる。

【0037】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調 A、B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 \geq C_2 \geq \dots \geq C_n$ であり、かつ、任意の k 番目（ $1 \leq k \leq n$ の整数）のオーバーシュートレベル C_k を、該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、 $C_{k+1} \sim C_n = B$ と決定することを特徴とする。

【0038】

上記の構成によれば、ライズ応答の場合、総てのフィールドにおけるオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ は、到達階調 B 以上であり、1 フィールド目から順にオーバーシュートレベル C_1, C_2, \dots を変化させて応答波形を観察し、該応答波形が前記到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最大値を探出することで、それぞれのフィールドにおける最適なオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0039】

そして、任意の k 番目のフィールドにおいて、応答波形が到達階調 B のレベルに達すると、以降はオーバーシュート駆動する必要がないので、 $C_{k+1} \sim C_n = B$ とすることで、総てのフィールドのオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0040】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 \leq C_2 \leq \dots \leq C_n$ であり、かつ、任意の k 番目（ $1 \leq k \leq n$ の整数）のオーバーシュートレベル C_k を、該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、 $C_{k+1} \sim C_n = B$ と決定することを特徴とする。

【0041】

上記の構成によれば、ディケイ応答の場合、総てのフィールドにおけるオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ は、到達階調 B 以下であり、1 フィールド目から順にオーバーシュートレベル C_1 、 C_2 、…を変化させて応答波形を観察し、該応答波形が前記到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値を探出することで、それぞれのフィールドにおける最適なオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0042】

そして、任意の k 番目のフィールドにおいて、応答波形が到達階調 B のレベルに達すると、以降はオーバーシュート駆動する必要がないので、 $C_{k+1} \sim C_n = B$ とすることで、総てのフィールドのオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0043】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $A < C_1 \leq \dots \leq C_k < B \leq C_{k+1} \leq \dots \leq C_n$ (k は $1 \leq k \leq n$ の整数) であり、かつ、任意の j 番目（ $k+1 \leq j$

$\leq n$ の整数 \geq のオーバーシュートレベル C_j を、該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、 $C_j + 1 \sim C_n = B$ と決定することを特徴とする。

【0044】

上記の構成によれば、液晶パネルは、その表示モード、スイッチング階調によつては、いきなり強いオーバーシュート信号を入力しても、満足に応答しない場合がある。たとえば、低温における垂直配向モードでは、特に黒からの立ち上がりが著しく応答性が悪い。このようなときには、本発明のように、先ず $1 \sim k$ 番目のフィールドにおいて、オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_k$ をわざと弱いアンダーシュートレベルとして液晶を少し応答させておいてから、以降の $k + 1 \sim n$ 番目のフィールドにおいて、オーバーシュートレベル $C_{k+1} \sim C_n$ を本来のオーバーシュートレベルにするといった方法が考えられる。本発明は、このようなオーバーシュート駆動法においても、オーバーシュートパラメータを正確に決定することができる。

【0045】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $A > C_1 \geq \dots \geq C_k > B \geq C_{k+1} \leq \dots \leq C_n$ (k は $1 \leq k \leq n$ の整数) であり、かつ、任意の j 番目 ($k + 1 \leq j \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_j を、該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、 $C_j + 1 \sim C_n = B$ と決定することを特徴とする。

【0046】

上記の構成によれば、ディケイ応答において、アンダーシュート駆動からオーバーシュート駆動を行う駆動法において、オーバーシュートパラメータを正確に決定することができる。

【0047】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調 A、B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 = C_2 = \dots = C_n$ であり、かつ、任意の k 番目 ($1 \leq k \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_k を、総てのオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最大値に決定することを特徴とする。

【0048】

上記の構成によれば、 n (多) フィールドオーバーシュート駆動においては、前記 $A \rightarrow C \rightarrow B$ レベルの駆動で、 C を n フィールド印加することと結果的には同じ効果が得られる駆動法として、 n フィールド総てに同一のオーバーシュート信号を印加する場合があり、ライズ応答のこのような場合におけるオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0049】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A、B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $B \geq C_1 = C_2 = \dots = C_n$ であり、かつ、任意の k 番目 ($1 \leq k \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_k を、総てのオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定することを特徴とする。

【0050】

上記の構成によれば、 n (多) フィールドオーバーシュート駆動においては、前記 $A \rightarrow C \rightarrow B$ レベルの駆動で、 C を n フィールド印加することと結果的には同じ効果が得られる駆動法として、 n フィールド総てに同一のオーバーシュート信号を印加する場合があり、ディケイ応答のこのような場合におけるオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0051】

また、本発明の液晶表示装置は、前記の評価装置によって決定されたオーバーシュートレベル C を、駆動回路がオーバーシュート駆動用のルックアップテーブルとしてストアしていることを特徴とする。

【0052】

上記の構成によれば、駆動回路が、使用される液晶パネルに最適なオーバーシ

ユードパラメータから成るルックアップテーブルを備えているので、高速応答が可能で、かつ映像の破綻が生じない液晶表示装置を実現することができる。

【0053】

さらにまた、本発明の液晶表示装置は、前記の評価装置によって決定されたオーバーシュートレベルC₁～C_nを、駆動回路がオーバーシュート駆動用のルックアップテーブルとしてストアしていることを特徴とする。

【0054】

上記の構成によれば、多フィールドに亘るオーバーシュート駆動を行う場合に、駆動回路が、使用される液晶パネルに最適なオーバーシュートパラメータから成るルックアップテーブルを備えているので、高速応答が可能で、かつ映像の破綻が生じない液晶表示装置を実現することができる。

【0055】

また、本発明の液晶表示装置の評価方法は、評価対象の液晶パネルにオーバーシュート信号を与え、その応答結果から、最適オーバーシュート信号レベルを評価する方法であって、階調を変化させる前の階調をAとし、到達させるべき階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをC（ただし、C=Bを含む）とするとき、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を前記液晶パネルに与え、表示させるステップと、前記映像信号による液晶パネルの表示画像を読取るステップと、読取った表示画像の波形解析を行うステップとを、前記オーバーシュートレベルCを掃引させつつ、繰返し行い、各オーバーシュートレベルCでの応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も速く到達したレベルを、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆくステップとを含むことを特徴とする。

【0056】

上記の構成によれば、液晶の応答性を向上するためのオーバーシュート駆動を行うにあたり、その最適オーバーシュートパラメータを決定するにあたって、先ず、階調を変化させる前の任意の階調をAとし、到達させるべき任意の階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをCとするとき、オーバーシュートレベルCを掃引させつつ、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次出力し、

液晶パネルに表示させる。

【0057】

そして、その出力に伴って、表示画像を読み取り、読み取った表示画像の波形解析を順次行う。その結果、過剰応答がなく、到達階調Bに最も早く到達したレベルを、前記最適オーバーシュートパラメータとして、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆく。

【0058】

したがって、その液晶パネルのオーバーシュート駆動用の駆動回路に、前記変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けて最適オーバーシュートパラメータCのルックアップテーブルをセットしておくことで、該駆動回路は、入力された映像信号の変化前の階調Aおよび到達階調Bから、前記LUTを参照して、最適オーバーシュートパラメータを決定し、前記液晶パネルを適切にオーバーシュート駆動することができる。

【0059】

このようにして、最適なオーバーシュートパラメータを、容易、かつ高精度に求めることができる。また、オーバーシュート駆動を行っていない液晶パネルに対しても、オーバーシュート信号を用いた測定が可能になり、後に該パネルに対してオーバーシュート駆動を導入するようになった場合、回路設計とOSパラメータCの決定との2つの作業が必要になるけども、本発明では、回路が出来上がっていなかった場合でも、すなわちオーバーシュート駆動ができない状態でも、オーバーシュート駆動用のパラメータを求めることができる。

【0060】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価方法では、前記オーバーシュート駆動はnフィールド期間に亘って行われ、映像信号発生回路は、nフィールド期間に亘るオーバーシュート信号のレベルを、順にC1, C2, …, Cn (nは1以上の任意の整数) とするとき、オーバーシュートレベルC1～Cnをそれぞれ掃引させつつ、A→C1～Cn→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネルに与えることを特徴とする。

【0061】

上記の構成によれば、オーバーシュート信号は、その印加期間中一定である必要はなく、たとえば低温において著しく液晶の応答が遅くなってしまう場合や、倍速駆動等において、多フィールドに亘るオーバーシュート駆動が考えられ、フィールド毎に異なったオーバーシュート信号を印加することで、その応用範囲を広げることができる。そこで、前記オーバーシュート信号のレベルを、順にC1, C2, …, Cn (nは1以上の任意の整数) として、前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調Aおよび到達階調Bを合わせて、(n+2)種類の信号を、それぞれ特定の時間だけこの順に出力する。

【0062】

これによって、多フィールドに亘るオーバーシュート駆動に対応したオーバーシュートパラメータを、正確かつ簡便に決定することができる。

【0063】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の一形態について、図1～図6および前記図11～図15に基づいて説明すれば、以下のとおりである。

【0064】

図1は、本発明の実施の一形態の評価装置1の全体構成を示す図である。この評価装置1は、評価対象の液晶パネル2にOS駆動による映像信号を与える映像信号発生回路3と、前記液晶パネル2の表示部に臨む光学受光素子4と、前記光学受光素子4からの出力が入力される波形解析装置5と、恒温槽6と、図示しない制御装置とを含んで構成される。

【0065】

前記制御装置は、前記映像信号発生回路3に、参照符6で示すように、階調を変化させる前の階調をAとし、到達させるべき階調をBとし、OS信号のレベルをC (ただし、C=Bを含む) とするとき、OS信号レベルCを掃引させつつ、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネル2に出力させ、これによって光学受光素子4で光電変換され、前記波形解析装置5において解析された応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も速く到達したレベルを、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けて、OSパラメータCとして

LUTにストアしてゆく。そのLUTを用いて、前記液晶パネル2を搭載する液晶表示装置7の駆動回路が該液晶パネル2のOS駆動を行うことで、適切なOS駆動が可能になる。メーカでは、液晶パネル2の機種毎に、このような評価が行われ、OSパラメータCが決定される。

【0066】

前記液晶パネル2は、コントローラ等の途中で信号変換がなされないようにすれば、そのコントローラにOS制御機能を搭載しているか否かは関係なく、実際にOS駆動を適用しようとしている機種の総ての評価を行うことができる。すなわち、映像信号発生回路3から液晶パネル2に映像信号を入力する際には、その信号に対して、液晶パネル2が正しい階調を出力できるような入力方法を用いる必要がある。たとえば、ビデオ入力端子から映像信号を入力した場合は、0～255の階調レンジで入力した映像信号が、前記コントローラによって、16～235の階調レンジに変換されてしまい、液晶パネル2に正しい階調で信号が入力されなくなる。

【0067】

そこで、先ず液晶パネル2にデジタル入力（ここでは最近の液晶パネルに装備されているDVIを例にする）がある場合、映像信号発生回路3にDVI出力を持たせ、前記映像信号発生回路3からの映像信号を液晶パネル2に入力するケーブル8を、DVIケーブルとすればよい。

【0068】

これに対して、液晶パネル2が前記デジタル入力を持たない場合、上述の通りビデオ入力端子からの入力では不適切であるので、該液晶パネル2のソースドライバに映像信号発生回路3からの映像信号を直接入力する方法を考える。たとえば、フレキシブル基板で接続されているコントローラとソースドライバとを切離し、その間に映像信号発生回路3をフレキシブル基板を介して挟込む。具体的には、前記コントローラからの信号をクロック用として映像信号発生回路3に取込み、映像信号発生回路3からの映像信号をソースドライバに直接入力するというものである。

【0069】

前記波形解析装置5は、光学受光素子4からの液晶パネル2の応答波形を取込み、解析するためのものであり、オシロスコープを使用することが一般的であるが、前記制御装置を構成するコンピュータに、応答波形を直接取込んでもかまわない。

【0070】

前記恒温槽6は、少なくとも液晶表示装置7を収納することができ、この図1で示すように、液晶パネル2とともに光学受光素子4を設置してもよく、または恒温槽6内に液晶パネル2を設置するとともに該恒温槽6に前記液晶パネルの表示部を外部から観察可能なように窓9を設け、その窓9に前記光学受光素子4を設けるなどして、前記表示結果を観察するようにしてもよい。恒温槽6は、前記制御装置などによって、液晶パネル2の評価に要求される、たとえば0～60℃の範囲で温度制御される。

【0071】

この恒温槽6を設けることで、液晶パネル2の評価を一定の温度条件で行うことができる。また、液晶パネル2を種々の環境温度で評価することができ、それぞれの温度に最適なOSパラメータCを求めるこどもできる。したがって、液晶パネル2の駆動回路に数温度分のLUTを用意しておき、また該液晶パネル2に温度センサを設けて、その検出結果に応じて参照LUTを変化させるという、細かなOS制御を行うことができる。

【0072】

さらに、恒温槽6の温度を大きく変化させる場合、過酷な温度サイクルが加わることになり、液晶パネル2の各部分に大きな負担が生じ、これがもとで、まれに点灯異常を起こすことがある。このため、恒温槽6に前記窓9を設けることで、測定者がこのような異常を速やかに発見でき、対策が講じ易くなる。

【0073】

図1では、前記映像信号発生回路3と、波形解析装置5と、制御装置とは、恒温槽6の外部に設置され、測定者の手元でスイッチ操作が可能であるようになっている。しかしながら、それらが恒温槽6の内部に設置され、スイッチ操作は恒温槽6の外部からリモートコントローラ等で行う形態であってもよい。

【0074】

図2は、前記映像信号発生回路3の一構成例を示すブロック図である。この映像信号発生回路3は、OS信号生成部11と、クロック信号入力部12と、スイッチ部13と、信号出力部14とを備えて構成される。前記OS信号生成部11は、前記スイッチ部13で設定された信号レベルA, B, Cに従い、クロック信号入力部12からのクロック信号に応答して、映像信号を生成する。すなわち、OS信号生成部11は、垂直走査周波数が、NTSC等の60Hzの信号が入力されれば60Hzでの映像信号を作成し、PAL等の50Hzの信号が入力されれば50Hzでの映像信号を作成する。前記スイッチ部13は、後述するような映像信号のレベルA, B, Cをそれぞれ独立に制御するための3系統のスイッチから成り、該スイッチをデジタル的にオン／オフ制御することで、スイッチング態様に対応した電圧を前記映像信号として順次出力する。このOS信号生成部11で生成された映像信号は、信号出力部14から、前記接続ケーブル8を介して、液晶パネル2に与えられる。

【0075】

OS信号レベルの決定に必要なパラメータを入力するスイッチ部13は、パソコン用コンピュータなどで実現され、該評価装置1の全体を制御する制御装置からの入力で代用されてもよい。このスイッチ部13は、映像信号が、前記図11で示すように、前記の3つの信号レベルA, B, Cから成る場合、前記3系統のスイッチから成り、たとえば最も精細なOS信号レベルCを設定する系統が8ビット、したがって256階調を表す場合、階調を変化させる前の階調Aおよび到達させるべき階調Bの系統が4ビット、したがって16階調毎の階調切換が可能となっている。

【0076】

これは、任意の階調間のスイッチングにおいてOS信号レベルを詳細に設定することが理想であり、LUTはスイッチング階調1階調毎に設定されることが望ましいけれども、実際には、LUTをOS駆動回路に組込む際に、ICやメモリのコストの関係から、あまり大きいICや膨大なメモリを使用できず、動作プログラムやLUTをあまり大きくできないという制約があることが多いためである

。したがって、現実のLUTは、上述のようにA, Bそれぞれで16階調毎程度しか設定ができず、その間は補間アルゴリズムで計算される。もちろん、ICやメモリの制約が緩ければ、A, Bを1階調毎に設定したLUTを使用してもよい。このため、任意の階調A, Bは、最低でも16階調毎に、好ましくは1階調毎に切換えられることが望ましく、これに対してOS信号レベルCは、1階調の変化でOS効果が違ってくるので、1階調毎の切換えが必要であり、各系統のスイッチのビット数は、上述のように選ばれている。

【0077】

こうして、前記3つの信号レベルA, B, Cを独立のスイッチによって調整可能とすることで、前記階調A, Bに対するスイッチ数をむやみに増加することなく、必要なOS信号レベルCを、簡便かつ詳細に設定することが可能になる。

【0078】

そしてさらに、各系統のスイッチは、粗調整用と微調整用との2種類のスイッチで構成されている。たとえば、非常に単純な例として、OS信号レベルC全体として前記8ビットとし、上位4ビットと下位4ビットとを別スイッチで独立に操作できるようにしておき、先ず上位4ビット分をオン／オフ切換えすることで大体のOS信号レベルCの大きさを見積もっておき（粗調）、その後下位4ビット分をオン／オフ切換えすることで詳細なOS信号レベルCを決定する（微調）。したがって、たとえば前記のように256通りあるOS信号レベルCを、短時間で高精度に決定することができる。

【0079】

また、前記OS信号レベルCを印加する時間は、実際のOS駆動回路の仕様に合わせる必要があり、たとえば前記NTSCなどの60Hz駆動での駆動回路では、1フィールドが16 msecであるので、OS信号印加時間は、この16 msecとなる。また、後述するように、複数フィールドに亘ってOS信号を印加する場合には、前記OS信号印加時間は、

$$(OS\text{信号が入力されるフィールド数}) \times (16\text{ msec})$$

で表される。同様に、PALなどの50Hz駆動での駆動回路では、1フィールドが20 msecであるので、OS信号印加時間は、

(O S 信号が入力されるフィールド数) × (2 0 m s e c)
で表される。

【0080】

その他、フレーム周波数を倍にする倍速駆動等、特殊な駆動回路を用いる場合は、それに応じた1フィールド期間を用いて計算すればよい。これらの駆動周波数は、外部からNTSC、PAL等の映像信号を入力して、そのクロックを用いるのが簡便である。倍速駆動等特殊条件の場合は、入力映像信号のクロックをベースとして必要なクロックを作成すればよい。もちろん、総ての場合において、前記クロック信号入力部12は、外部入力に頼らずにクロックを回路内部で作成し、回路に設けたスイッチでクロックを選択するようにしてもよい。

【0081】

図3は、前記図11で示すような映像信号の作成動作を説明するためのフローチャートである。ステップS1～S3のそれぞれにおいて、前記3つの信号レベルA、B、Cに対応した各系統のスイッチから、信号レベルが設定される。ステップS4では、クロック信号入力部12からクロック信号が取込まれ、ステップS5では、そのクロック信号に応答して、前記各系統のスイッチで設定されたレベルで、かつA→C→Bの順でレベルが変化する映像信号が outputされる。前記変化前の階調Aの信号は予め定める一定期間、前記O S信号レベルCの信号は1フィールド期間、到達階調Bの信号は予め定める一定期間、それぞれ出力される。そして、ステップS6で、これらの信号が信号出力部14から液晶パネル2に出力される。

【0082】

前記液晶パネル2の一部または全体の表示領域（図1では参照符10で示すように、一部の表示領域を示している）で、前記映像信号による表示が行われ、その表示結果を光学受光素子4で取込み、波形解析装置5で解析されると、他のO S信号レベルCについて、前記ステップS1～S6の処理が繰返し行われる。その解析結果が前記図示しない制御装置などに取込まれ、各階調A、B毎に最適なO SパラメータCが決定され、LUTが作成される。

【0083】

前記恒温槽6内の温度を25℃に保って、前記図11に示した映像信号による液晶パネル2のスイッチングの光学応答波形を、前記光学受光素子4としてフォトダイオードを用い、前記波形解析装置5としてのオシロスコープに取込み、解析した結果の一例を示すのが前記図12～図15である。これらの図12～図15において、前記変化前の階調Aは64階調、到達階調Bは192階調で一定である。

【0084】

先ず、図15は、OS駆動をしないとき、すなわちOS信号レベルCが到達階調Bと同一レベルであるときの波形である。ここからOS信号レベルCを徐々に上げると、やや弱いOS駆動のかかった応答波形が得られ、これを前記図14に示す。さらにOS信号レベルCを上げると、充分なOS駆動のかかった応答波形が得られ、これを前記図12に示す。さらにOS信号レベルCを上げると、前記図13に示すように、応答波形に角が見え始めるようになる。このとき、応答波形が到達階調Bを上回ってしまうので、人間の目には目的階調が表示される直前に白く光って見える。このように過剰応答をしない直前の状態、すなわち前記図12に示される状態が最適なOS信号レベルと判定できる。

【0085】

表1には、上述のような手法で決定された任意の階調間A、BにおけるOSパラメータCの一例を示す。この表1のLUTが、液晶パネル2のコントローラにストアされることで、中間調～中間調を含む任意の階調間で、最適なOS駆動が可能になる。

【0086】

【表 1】

		到達階調								
		0	32	64	96	128	160	192	224	255
スタート階調	0	0	125	168	193	213	225	234	247	255
	32	0	32	104	138	176	198	221	240	255
	64	0	15	64	113	160	188	216	238	255
	96	0	9	35	96	148	181	212	237	255
	128	0	5	17	57	128	170	206	234	255
	160	0	4	12	32	114	160	200	232	255
	192	0	3	9	22	99	147	192	228	255
	224	0	2	7	15	77	133	185	224	255
	255	0	0	4	10	47	117	174	218	255

【0087】

また、表2には、前記表1で示す最適OSパラメータCの信号レベルが入力されているフィールドの終了時点における応答波形の到達率の計算結果を示す。この表2から明らかなように、到達率はほぼ全ての階調で100%に近い値を示し、必要充分なOS信号が与えられていることが確認された。

【0088】

【表 2】

		到達階調								
		0	32	64	96	128	160	192	224	255
スタート階調	0	97.08	98.88	97.88	97.89	97.63	99.18	97.71	80.64	
	32	96.71	89.29	96.02	99.38	97.7	97.48	98.53	88.14	
	64	97.36	94.03	98.67	98.99	99.06	98.44	98.98	90.35	
	96	97.11	97.98	99.3	100.6	99.88	98.49	99.7	91.57	
	128	97.19	99.43	99.08	97.64	98.79	98.12	97.92	91.14	
	160	97.52	98.16	98.53	97.67	97.52	97.18	98.42	91.34	
	192	97.07	97.02	96.71	95.86	94.71	93.83	98.05	91.54	
	224	96.52	96.57	95.92	95.16	94.19	95.15	95.84	92.25	
	255	96.2	97.8	97.34	95.89	95.36	96.02	97.95	98.57	

【0089】

ここで、比較例として、従来技術に記載のように、通常の駆動法において液晶パネル2の応答波形を測定し、トリガーポイントからOS信号を印加するフィールド数分（上記の例では1フィールド分）の時間後の階調到達率を算出して、その結果から、OSパラメータCを計算によって求めたLUTを表3に示す。また、前記表2と同様に、このLUTを用いてOS駆動を行い、その波形からOS信号が入力されているフィールドにおける応答波形の到達率を計算したものを、表4に示す。

【0090】

【表3】

		到達階調									
		0	32	64	96	128	160	192	224	255	
スタート階調	0	0	115	168	195	210	224	233	247	255	
	32	0	32	121	159	185	209	224	243	255	
	64	0	12	64	126	164	193	217	240	255	
	96	0	9	31	96	145	181	211	237	255	
	128	0	6	20	70	128	171	206	235	255	
	160	0	3	13	46	108	160	200	232	255	
	192	0	0	11	27	82	144	192	228	255	
	224	0	0	8	15	54	123	181	224	255	
	255	0	0	5	12	31	102	171	218	255	

【0091】

【表4】

		到達階調									
		0	32	64	96	128	160	192	224	255	
スタート階調	0	56.38	72.65	93.77	79	93.2	83.45	90.12	84.07		
	32	97.16	125.9	136.9	116	116	100.1	97.36	88.18		
	64	97.35	95.06	137.4	102.7	104.7	96.97	100.9	90.45		
	96	97.64	100.1	103.6	87.27	94.14	91.83	97.65	91.51		
	128	97.94	100.4	93.39	85.95	89.52	93.03	95.03	91.77		
	160	97.97	102.1	96.13	90.48	105.2	94.88	98.6	91.76		
	192	97.77	100.3	97.57	92.55	102.2	96.57	94.7	92.15		
	224	97.33	99.31	94.71	96.61	99.71	102.5	106.3	91.88		
	255	96.75	98.01	97.21	93.9	97.96	102.6	102.1	101.1		

【0092】

表1と表3および表2と表4とをそれぞれ比較して明らかのように、従来技術によるLUTでは、前記図14のようなOS信号のレベルが充分でなく、OS信号印加期間の到達率が100%にはるかに足りない階調や、前記図13のようにOS信号が過剰になっており、OS信号印加期間の到達率が100%をオーバーしてしまう階調が多々観察され、LUTとしては不完全であることが分かった。

【0093】

図4に、本発明に係るLUTを用いたOS駆動による表示結果の一例を示す。この例では、前記変化前の階調Aとしては、画面の上側から下側になるにつれて徐々に白くなるグレースケールGを表示させ、その上に適當な幅を持った任意の到達階調Bのバーを、OS信号Cを伴って、左から右にスクロールさせている。前記スクロールバーは、グレースケールGの階調レベルの最大値（白）と最小値（黒）との間の値である。

【0094】

この図4から、背景が任意の階調のグレースケールGであっても、スクロールバーを一定の濃度に維持して、OS制御の効果を確認することができる。なお、前記B, CおよびGのレベルは、外部回路によってそれぞれ独立に切換えられるようにした。また、前述のように、到達階調Bは16階調刻みで階調切換えを行

えるようにし、OSパラメータCは1階調刻みで階調切換えを行えるようにしている。

【0095】

また、図5には、前記スクロールバーを階調レベルの最小値の黒とした表示結果を示している。比較例として、図6には、まったくOS駆動をかけなかったときの表示結果を示す。これらの図5および図6から明らかなように、OS信号を与えない場合に比較して、適正なOS信号を与えた画像は、応答が遅い場合に顕著となる尾引き現象が大幅に緩和されており、また、見え方も自然である。また、OS駆動が正しく効いていれば、どの階調のバーでも、OS過剰による白びかり（または黒沈み）、OS不足による尾引きの影響が最小限になるので、決定したOSパラメータの正当性を、これらの図4～図6で示すようなパターンで、ある程度評価することができる。

【0096】

以上のようにして、本発明では、最適なOSパラメータCを、容易、かつ高精度に求めることができる。また、OS駆動を行っていない液晶パネルに対しても、OS信号を用いた測定が可能になり、後に該パネルに対してOS駆動を導入するようになった場合、回路設計とOSパラメータCの決定との2つの作業が必要になるけども、本発明では、回路が出来上がっていな場合でも、すなわちOS駆動ができない状態でも、OS駆動用のパラメータCを求めることができる。

【0097】

なお、上述の説明では、前記図11で示すようなライズ応答、すなわち $A < B$ の例を示しているけれども、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、OS信号レベルCは前記到達階調B以下であり、Cを変化させて応答波形を観察し、応答波形がBのレベルに対して過剰応答しない最小のCを探出することで、正確なOSパラメータCを決定することができる。

【0098】

本発明の実施の他の形態について、図7～図11に基づいて説明すれば、以下のとおりである。

【0099】

本実施の形態で注目すべきは、OS駆動をn（nは1以上の任意の整数）、すなわち多フィールド期間に分割して行うことである。このような駆動は、所望とする階調変化が1フィールドで困難な場合に行われ、何フレームかに亘って、最終的な到達階調Bに向けて、調整が行われる。

【0100】

ここで、時間経過に伴うOS信号レベルを順に、C1, C2, …, Cnとするとき、前記A < Bであるライズ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、C1～Cnが、図7で示すように $B \leq C_1 \geq C_2 \geq \cdots \geq C_n$ の場合と、図8で示すように $A < C_1 \leq \cdots \leq C_k < B \leq C_{k+1} \geq \cdots \geq C_n$ (kは $1 \leq k \leq n$ の整数) の場合と、図9で示すように $B \leq C_1 = C_2 = \cdots = C_n$ の場合とがある。なお、図7～図9および以下の説明では、n = 3としている。

【0101】

同様に、ディケイ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、C1～Cnが、前記図7に対応する $B \geq C_1 \leq C_2 \leq \cdots \leq C_n$ の場合と、前記図8に対応する $A > C_1 \geq \cdots \geq C_k > B \geq C_{k+1} \leq \cdots \leq C_n$ の場合と、前記図9に対応する $B \geq C_1 = C_2 = \cdots = C_n$ の場合とがある。

【0102】

前述の図11で示すような1フィールドOSと、これらの図7～図9で示すような多フィールドOSとを同時に処理することは、回路規模から考えると、あまり望ましいことではないけれども、多フィールドOSを選択した場合に、特にC1, C2, …と大きくパラメータが変化する階調遷移が存在する場合、この多フィールドOSが有効である。

【0103】

図10は、前記図7～図9で示すような映像信号の作成動作を説明するためのフローチャートである。この動作は、前述の図1で示す評価装置1において、映像信号発生回路3が、3つのOS信号レベルC1, C2, C3のそれぞれを個別に設定するスイッチを備え、A → C1 → C2 → C3 → Bの順でレベルが変化する映像信号を出力し、波形解析装置5が、それによって得られたOSパラメータC1, C2, C3をストアすることで実現することができる。そして、この図3に

おいて、図2の動作に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して、その説明を省略する。

【0104】

本実施の形態では、ステップS1, S2では前記信号レベルA, Bが設定され、またステップS31～S33では前記3つのOS信号レベルC1～C3が設定される。そして、ステップS50では、前記ステップS4で入力されたクロック信号に応答して、前記各系統のスイッチで設定されたレベルで、かつ前記A→C1→C2→C3→Bの順でレベルが変化する映像信号が出力され、ステップS6でこれらの信号が信号出力部14から液晶パネル2に出力される。

【0105】

このように各OS信号レベルC1～C3を設定するスイッチも各系統間で独立とし、かつ、それぞれのスイッチを粗調整用と微調整用との2種類で構成することで、たとえば前述のように全階調で256階調の場合、1階調毎に切換えられる必要のあるOS信号レベルC1～C3は、合計で $256 \times n$ 通りとなり、これを1階調毎に変化させての評価は時間がかかるのに対して、短時間で正確な測定が可能となる。

【0106】

ここで、表5に、1フィールドOSで得られたOSパラメータCのLUTを示し、その液晶パネルを多フィールドOSで駆動する方法を考える。

【0107】

【表5】

		到達階調									
		0	32	64	96	128	160	192	224	255	
スタート階調	0	0	204	228	242	251	255	255	255	255	
	32	0	32	140	188	217	233	244	253	255	
	64	0	7	64	145	191	219	236	249	255	
	96	0	3	18	96	160	202	227	245	255	
	128	0	0	9	55	128	183	218	241	255	
	160	0	0	4	21	95	160	206	237	255	
	192	0	0	1	11	59	136	192	231	255	
	224	0	0	0	6	22	102	171	224	255	
	255	0	0	0	0	8	33	130	207	255	

【0108】

先ず、図7で示すように、ライズ応答の場合で $B \leq C_1 \geq C_2 \geq \dots \geq C_n$ 、ディケイ応答の場合で $B \geq C_1 \leq C_2 \leq \dots \leq C_n$ のように、始めのOS信号レベル C_1 が最も大きく、以降は徐々に小さくなつてゆく駆動は、低温等で1フィールドOSによって応答が完了しないときに効果があり、表5のLUTにおいて、斜線部分がこの駆動法に適している。たとえば、ディケイ応答で $192 \rightarrow 32$ への階調遷移を考えた場合、1フィールドだけのOS駆動では 32 階調までは到達できず、そこで多フィールドOSでは、 C_1 として 0 を与え、最大限に液晶を応答させ、次に C_2 として、最も 32 に近い遷移を与える値を探し、図示しないけれども、前記 C_1 での到達階調から、8で 32 に到達する。この場合、 C_3 以降は 32 となり、 $C_3 = B$ である。すなわち、 $B(32) > C_1(0) < C_2(8) < C_3(32) = \dots = B(32)$ である。ライズ応答の場合、この逆のようになる（ただし、ライズ応答は、応答性が良く、 $32 \rightarrow 192$ では、 $C_1 = 244$ とすれば、 $C_2 = C_3 = \dots = B = 192$ があるので、 $0 \rightarrow 255, 224$ 等）。

【0109】

次に、図8で示すように、ライズ応答の場合で $A < C_1 \leq \dots \leq C_k < B \leq C_k + 1 \geq \dots \geq C_n$ 、ディケイ応答の場合で $A > C_1 \geq \dots \geq C_k > B \geq C_{k+1} \leq \dots \leq C_n$ のように、1～k番目のフィールドにおいて、OS信号レベル $C_1 \sim C_k$

をわざと弱いアンダーシュートレベルとして液晶を少し応答させておいてから、以降の $k + 1 \sim n$ 番目のフィールドにおいて、OS 信号レベル $C_{k+1} \sim C_n$ を本来のオーバーシュートレベルにするという駆動は、特に液晶がスイッチングしにくい領域で効果があり、表5の LUTにおいて、網掛け部分がこの駆動法に適している。この部分のデータは、何らかの原因で液晶の応答が起こりにくく、1 フィールド OS では OS 量が異常に大きいのが特徴である。したがって、強引に大きな OS 量でスイッチングさせているせいか、2 フィールド目以降に OS 信号が切れると、表示階調レベルが大きくドロップしてしまい、しばらくした後に再び所定の階調レベルに達する。この LUT は、VA タイプの液晶のデータであり、0 階調、すなわち液晶分子が完全に垂直配向している状態からのスイッチングは、スイッチング信号印加直後に、液晶が倒れる方向が決まるまでに少なからぬタイムラグが存在することに起因している。

【0110】

ここで、 $0 \rightarrow 96$ の階調遷移を考えた場合、先ず C_1 として 32 を与え、これによって、液晶分子をわずかにチルトさせておき、次に C_2 として 200 を与えることによって、96 階調への遷移がスムーズに行われる。また、これで 96 に到達したので、 C_3 以降は 96 となり、OS 駆動は終了することになるが、1 フィールドだけでの OS 駆動で見られた階調レベルのドロップは、大幅に解消される。すなわち、上記のライズ応答の場合、 $A(0) < C_1(32) < B(96) < C_2(200)$ となる。ディケイ応答は、この逆となる。

【0111】

続いて、図9で示すように、ライズ応答の場合で $B \leq C_1 = C_2 = \dots = C_n$ 、ディケイ応答の場合で $B \leq C_1 = C_2 = \dots = C_n$ のように、総ての OS 信号レベルが等しくなる駆動は、前記図7および図8を含む総ての駆動で有効である。すなわち、別々のパラメータを設定するよりも、総て同じパラメータを設定できる分、測定が容易になる。

【0112】

以上のように、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調 A、B に対して、OS 信号レベル $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 \geq C_2 \geq \dots \geq C_n$ であり、かつ、任意の

k 番目のOS信号レベル C_k を、該OS信号レベル C_k による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該OS信号レベル C_k による応答波形が到達階調Bのレベルにはほぼ等しくなっていれば、 $C_{k+1} \sim C_n = B$ と決定し、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、OS信号レベル $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 \leq C_2 \leq \dots \leq C_n$ であり、かつ、任意の k 番目のOS信号レベル C_k を、該OS信号レベル C_k による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該OS信号レベル C_k による応答波形が到達階調Bのレベルにはほぼ等しくなっていれば、 $C_{k+1} \sim C_n = B$ と決定することで、前記図7で示すような、始めのOS信号レベル C_1 が最も大きく、以降は徐々に小さくなってゆく多フィールドOSを実現することができ、低温等で1フィールドOSによって応答が完了しないときに効果的である。

【0113】

また、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、OS信号レベル $C_1 \sim C_n$ を、 $A < C_1 \leq \dots \leq C_k < B \leq C_{k+1} \geq \dots \geq C_n$ であり、かつ、任意の j 番目（ $k+1 \leq j \leq n$ の整数）のOS信号レベル C_j を、該OS信号レベル C_j による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該OS信号レベル C_j による応答波形が到達階調Bのレベルにはほぼ等しくなっていれば、 $C_{j+1} \sim C_n = B$ と決定し、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、OS信号レベル $C_1 \sim C_n$ を、 $A > C_1 \geq \dots \geq C_k > B \geq C_{k+1} \leq \dots \leq C_n$ であり、かつ、任意の j 番目のOS信号レベル C_j を、該OS信号レベル C_j による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該OS信号レベル C_j による応答波形が到達階調Bのレベルにはほぼ等しくなっていれば、 $C_{j+1} \sim C_n = B$ と決定することで、前記図8で示すような、 $1 \sim k$ 番目のフィールドにおいて、OS信号レベル $C_1 \sim C_k$ をわざと弱いアンダーシュートレベルとして液晶を少し応答させておいてから、以降の $k+1 \sim n$ 番目のフィールドにおいて、OS信号レベル $C_{k+1} \sim C_n$ を本来のオーバーシュートレベルにする多フィールドOSを実現することができ、液晶がスイッチングしにくい領域で効果的である。

【0114】

さらにまた、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、OS信号レベル $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 = C_2 = \dots = C_n$ であり、かつ、任意のk番目のOS信号レベル C_k を、総てのOS信号レベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、 $A > B$ であるデイケイ応答の場合、OS信号レベル $C_1 \sim C_n$ を、 $B \geq C_1 = C_2 = \dots = C_n$ であり、かつ、任意のk番目のOS信号レベル C_k を、総てのOS信号レベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最小値に決定することで、前記図9で示すような、総て同じパラメータを設定する多フィールドOSを実現することができる。

【0115】

そして、上述のようにして求められたLUTを液晶パネル2のコントローラに搭載することで、高速応答が可能で、かつ映像の破綻が生じない液晶表示装置を実現することができる。

【0116】

なお、上述の説明では、到達階調Bを与えていたるけれども、OS駆動を制動させるために機能するこの到達階調Bは、必ずしも与えられなくてもよい。すなわち、 $C = B$ であり、特に大きな階調変化時にはOS駆動期間の終了時点でも前記到達階調Bに達しない場合もあり、このような場合には該到達階調Bを与えないでも、最適OS信号レベルを決定することができる。しかしながら、階調変化に余裕のある場合は、上記のようにOS駆動を制動させるために機能するこの到達階調Bを与えることで、高精度に測定することができる。したがって、特に低階調領域や低温では、ノイズの影響が大きいので、前記到達階調Bを与えて精度を高めることは、有効である。

【0117】

また、本発明はOS駆動による測定を行うことを目的にしているけれども、たとえば本発明の評価装置1を既存の液晶パネルの評価装置に組込むことによって、従来の評価とOS駆動での評価との双方を行うことが可能な液晶評価装置を作成することが可能である。たとえば、電圧-輝度特性を測定する装置と組合わせるといったことが可能である。

【0118】

本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、液晶パネルのOS駆動レベルを決定するにあたって、広く実施することができる。

【0119】**【発明の効果】**

本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、液晶の応答性を向上するためのオーバーシュート駆動を行うにあたり、その最適オーバーシュートパラメータを決定するにあたって、先ず、映像信号発生回路から、階調を変化させる前の任意の階調をAとし、到達させるべき任意の階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをCとするとき、オーバーシュートレベルCを掃引させつつ、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次出力し、次にそれぞれの映像信号による液晶パネルの表示画像を光学受光素子で光電変換し、続いて波形解析装置が、掃引された種々のオーバーシュートレベルCの映像信号による液晶パネルの表示結果の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も速く到達したレベルを、前記最適オーバーシュートパラメータとして、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆく。

【0120】

それゆえ、最適なオーバーシュートパラメータを、容易、かつ高精度に求めることができる。また、オーバーシュート駆動を行っていない液晶パネルに対しても、オーバーシュート信号を用いた測定が可能になり、後に該パネルに対してオーバーシュート駆動を導入するようになった場合、回路設計とオーバーシュートパラメータの決定との2つの作業が必要になるけども、本発明では、回路が出来上がっていない場合でも、すなわちオーバーシュート駆動ができない状態でも、オーバーシュート駆動用のパラメータを求めることができる。

【0121】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、映像信号発生回路は、オーバーシュート信号のレベルを、順にC1, C2, …, Cn (nは1以上の任意の整数) とするとき、オーバーシュートレベルC1～Cnをそれぞれ掃引させつつ、A→C1～Cn→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶

パネルに与え、前記波形解析装置は、前記オーバーシュートレベルC1～Cnを掃引させた応答波形の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も速く到達したレベルを、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆく。

【0122】

それゆえ、前記オーバーシュート駆動をnフィールド期間に亘って行うことができ、応用範囲を広げることができる。

【0123】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、恒温槽を設け、少なくとも前記液晶パネルを収納する。

【0124】

それゆえ、液晶パネルの評価を一定の温度条件で行うことができる。また、液晶パネルを種々の環境温度で評価することができ、それぞれの温度に最適なオーバーシュートパラメータを求める 것도できる。さらに、恒温槽に窓を設けた場合、評価時の異常を速やかに発見でき、対策を講じ易くなる。

【0125】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルCのそれぞれに対応して設けられるスイッチを備え、該スイッチをデジタル的にオン／オフ制御することで、スイッチング態様に対応した電圧を前記映像信号として順次出力する。

【0126】

それゆえ、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルCのそれぞれを、スイッチの設定によって、任意かつ独立にデジタル的に調整することができる。前記スイッチは、多ビットスイッチが望ましく、この場合、任意階調間のスイッチングにおいて、オーバーシュートレベルCを詳細に設定することができる。

【0127】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、前記オーバーシュートレベルCを調整するスイッチを、粗調整用と微調整用との2種類のス

イッチで構成する。

【0128】

それゆえ、短時間で正確な評価が可能となる。

【0129】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、前記映像信号発生回路は、前記変化前の階調A、到達階調BおよびオーバーシュートレベルC₁～C_nのそれぞれに対応して設けられるスイッチを備え、該スイッチをデジタル的にオン／オフ制御することで、スイッチング態様に対応した電圧を前記映像信号として順次出力する。

【0130】

それゆえ、n（多）フィールドオーバーシュートレベルC₁～C_nのそれぞれを、スイッチの設定によって、任意かつ独立にデジタル的に調整することができる。前記スイッチは、多ビットスイッチが望ましく、この場合、任意階調間のスイッチングにおいて、オーバーシュートレベルC₁～C_nを詳細に設定することが可能である。

【0131】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、前記オーバーシュートレベルC₁～C_nを調整するスイッチを、粗調整用と微調整用との2種類で構成する。

【0132】

それゆえ、多フィールドのオーバーシュートレベルC₁～C_nの短時間で正確な評価が可能となる。

【0133】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、A < Bであるライズ応答の場合、任意の階調A、Bに対して、C₁～C_nを、B ≤ C₁ ≥ C₂ ≥ … ≥ C_nであり、かつ、任意のk番目（1 ≤ k ≤ nの整数）のオーバーシュートレベルC_kを、該オーバーシュートレベルC_kによる応答波形が到達階調Bのレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該オーバーシュートレベルC_kによる応答波形が到達階調Bのレベルにはほぼ等しくなっていれば、C_{k+1}～C

$n = B$ と決定する。

【0134】

それゆえ、ライズ応答で、始めのオーバーシュートレベル C_1 が最も大きくなる多フィールドオーバーシュート駆動におけるそれぞれのフィールドでの最適なオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0135】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $B \geq C_1 \leq C_2 \leq \dots \leq C_n$ であり、かつ、任意の k 番目（ $1 \leq k \leq n$ の整数）のオーバーシュートレベル C_k を、該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_k による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、 $C_k + 1 \sim C_n = B$ と決定する。

【0136】

それゆえ、ディケイ応答で、始めのオーバーシュートレベル C_1 が最も大きくなる多フィールドオーバーシュート駆動におけるそれぞれのフィールドでの最適なオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0137】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $A < C_1 \leq \dots \leq C_k < B \leq C_{k+1} \leq \dots \leq C_n$ （ k は $1 \leq k \leq n$ の整数）であり、かつ、任意の j 番目（ $k+1 \leq j \leq n$ の整数）のオーバーシュートレベル C_j を、該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最大値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、 $C_{j+1} \sim C_n = B$ と決定する。

【0138】

それゆえ、ライズ応答で、先ず $1 \sim k$ 番目のフィールドにおいて、オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_k$ をわざと弱いアンダーシュートレベルとして液晶を少し応答させておいてから、以降の $k+1 \sim n$ 番目のフィールドにおいて、オーバー

シュー・トレベル $C_{k+1} \sim C_n$ を本来のオーバーシュートレベルにするといった駆動法において、オーバーシュートパラメータを正確に決定することができる。

【0139】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $A > C_1 \geq \dots \geq C_k > B \geq C_{k+1} \leq \dots \leq C_n$ (k は $1 \leq k \leq n$ の整数) であり、かつ、任意の j 番目 ($k+1 \leq j \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_j を、該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定し、かつ該オーバーシュートレベル C_j による応答波形が到達階調 B のレベルにほぼ等しくなっていれば、 $C_{j+1} \sim C_n = B$ と決定する。

【0140】

それゆえ、ディケイ応答で、先ず $1 \sim k$ 番目のフィールドにおいて、オーバーシュートレベル $C_1 \sim C_k$ をわざと弱いアンダーシュートレベルとして液晶を少し応答させておいてから、以降の $k+1 \sim n$ 番目のフィールドにおいて、オーバーシュートレベル $C_{k+1} \sim C_n$ を本来のオーバーシュートレベルにするといった駆動法において、オーバーシュートパラメータを正確に決定することができる。

【0141】

また、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、 $A < B$ であるライズ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 = C_2 = \dots = C_n$ であり、かつ、任意の k 番目 ($1 \leq k \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_k を、総てのオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最大値に決定する。

【0142】

それゆえ、 n フィールド総てに同一のオーバーシュート信号を印加するライズ応答の場合におけるオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0143】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価装置は、以上のように、 $A > B$ であるディケイ応答の場合、任意の階調 A 、 B に対して、 $C_1 \sim C_n$ を、 $B \leq C_1 =$

$C_2 = \dots = C_n$ であり、かつ、任意の k 番目 ($1 \leq k \leq n$ の整数) のオーバーシュートレベル C_k を、総てのオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ による応答波形が到達階調 B のレベルに対して過剰応答しない最小値に決定する。

【0144】

それゆえ、 n フィールド総てに同一のオーバーシュート信号を印加するディケイ応答の場合におけるオーバーシュートパラメータを決定することができる。

【0145】

また、本発明の液晶表示装置は、以上のように、前記の評価装置によって決定されたオーバーシュートレベル C を、駆動回路にオーバーシュート駆動用のルックアップテーブルとしてストアしておく。

【0146】

それゆえ、駆動回路が、使用される液晶パネルに最適なオーバーシュートパラメータから成るルックアップテーブルを備えているので、高速応答が可能で、かつ映像の破綻が生じない液晶表示装置を実現することができる。

【0147】

さらにまた、本発明の液晶表示装置は、以上のように、前記の評価装置によって決定されたオーバーシュートレベル $C_1 \sim C_n$ を、駆動回路にオーバーシュート駆動用のルックアップテーブルとしてストアしておく。

【0148】

それゆえ、多フィールドに亘るオーバーシュート駆動を行う場合に、駆動回路が、使用される液晶パネルに最適なオーバーシュートパラメータから成るルックアップテーブルを備えているので、高速応答が可能で、かつ映像の破綻が生じない液晶表示装置を実現することができる。

【0149】

また、本発明の液晶表示装置の評価方法は、以上のように、液晶の応答性を向上するためのオーバーシュート駆動を行うにあたり、その最適オーバーシュートレベルを決定するにあたって、先ず、階調を変化させる前の任意の階調を A とし、到達させるべき任意の階調を B とし、オーバーシュート信号のレベルを C とするとき、オーバーシュートレベル C を掃引させつつ、 $A \rightarrow C \rightarrow B$ の順でレベルが

変化する映像信号を順次出力して液晶パネルに表示させ、次にその出力に伴って、表示画像を読み取って波形解析を順次行い、続いて過剰応答がなく、到達階調Bに最も早く到達したレベルを、前記最適オーバーシュートレベルとして、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆく。

【0150】

それゆえ、最適なオーバーシュートパラメータを、容易、かつ高精度に求めることができる。また、オーバーシュート駆動を行っていない液晶パネルに対しても、オーバーシュート信号を用いた測定が可能になり、後に該パネルに対してオーバーシュート駆動を導入するようになった場合、回路設計とOSパラメータの決定との2つの作業が必要になるけども、本発明では、回路が出来上がっていないうちでも、すなわちオーバーシュート駆動ができない状態でも、オーバーシュート駆動用のパラメータを求めることができる。

【0151】

さらにまた、本発明の液晶表示装置の評価方法は、以上のように、前記オーバーシュート駆動をnフィールド期間に亘って行い、映像信号発生回路は、nフィールド期間に亘るオーバーシュート信号のレベルを、順にC1, C2, …, Cn (nは1以上の任意の整数) とするとき、オーバーシュートレベルC1～Cnをそれぞれ掃引させつつ、A→C1～Cn→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次前記液晶パネルに与える。

【0152】

それゆえ、多フィールドに亘るオーバーシュート駆動に対応したオーバーシュートパラメータを、正確かつ簡便に決定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の一形態の評価装置の全体構成を示す図である。

【図2】

図1で示す評価装置における映像信号発生回路の一構成例を示すブロック図である。

【図3】

1 フィールドオーバーシュート駆動のための映像信号の作成動作を説明するためのフローチャートである。

【図 4】

適正な LUT を用いてオーバーシュート駆動を行ったときのスクロールの様子を示す図である。

【図 5】

オーバーシュート駆動の効果を確認するためのスクロールパターンの例である。

【図 6】

オーバーシュート駆動を行わないときのスクロールの様子を示す図である。

【図 7】

3 フィールドオーバーシュート駆動によるスイッチングを行うための信号の一例を示す波形図である。

【図 8】

3 フィールドオーバーシュート駆動によるスイッチングを行うための信号の他の例を示す波形図である。

【図 9】

3 フィールドオーバーシュート駆動によるスイッチングを行うための信号のさらに他の例を示す波形図である。

【図 10】

多フィールドオーバーシュート駆動のための映像信号の作成動作を説明するためのフローチャートである。

【図 11】

1 フィールドオーバーシュート駆動によるスイッチングを行うための信号の例を示す波形図である。

【図 12】

適正なオーバーシュート信号でオーバーシュート駆動を行ったときの液晶パネルのスイッチングによる光学応答波形である。

【図 13】

過剰なオーバーシュート信号でオーバーシュート駆動を行ったときの液晶パネルのスイッチングによる光学応答波形である。

【図 1 4】

弱いオーバーシュート信号でオーバーシュート駆動を行ったときの液晶パネルのスイッチングによる光学応答波形である。

【図 1 5】

オーバーシュート駆動を行わないときの液晶パネルのスイッチングによる光学応答波形である。

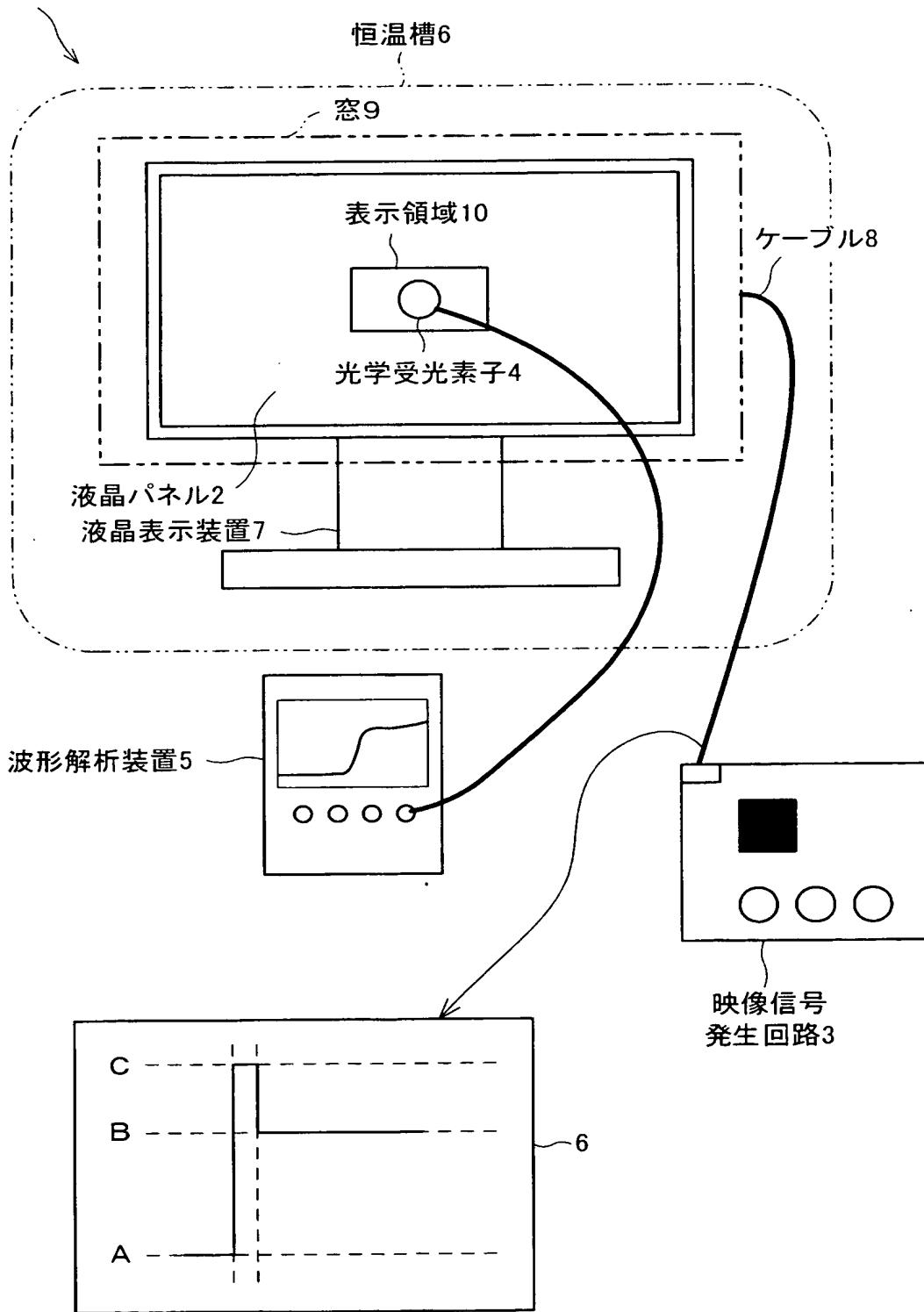
【符号の説明】

- 1 評価装置
- 2 液晶パネル
- 3 映像信号発生回路
- 4 光学受光素子
- 5 波形解析装置
- 6 恒温槽
- 7 液晶表示装置
- 9 眩
- 1 1 O S 信号生成部
- 1 2 クロック信号入力部
- 1 3 スイッチ部
- 1 4 信号出力部

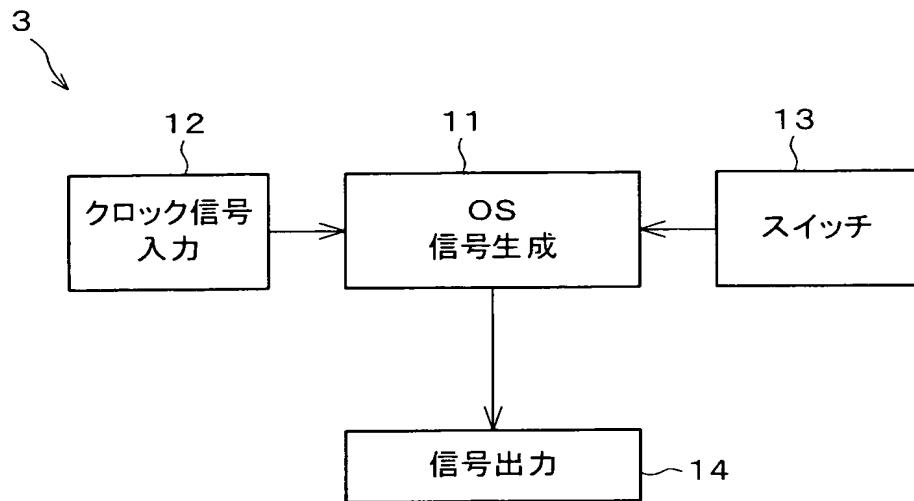
【書類名】 図面

【図 1】

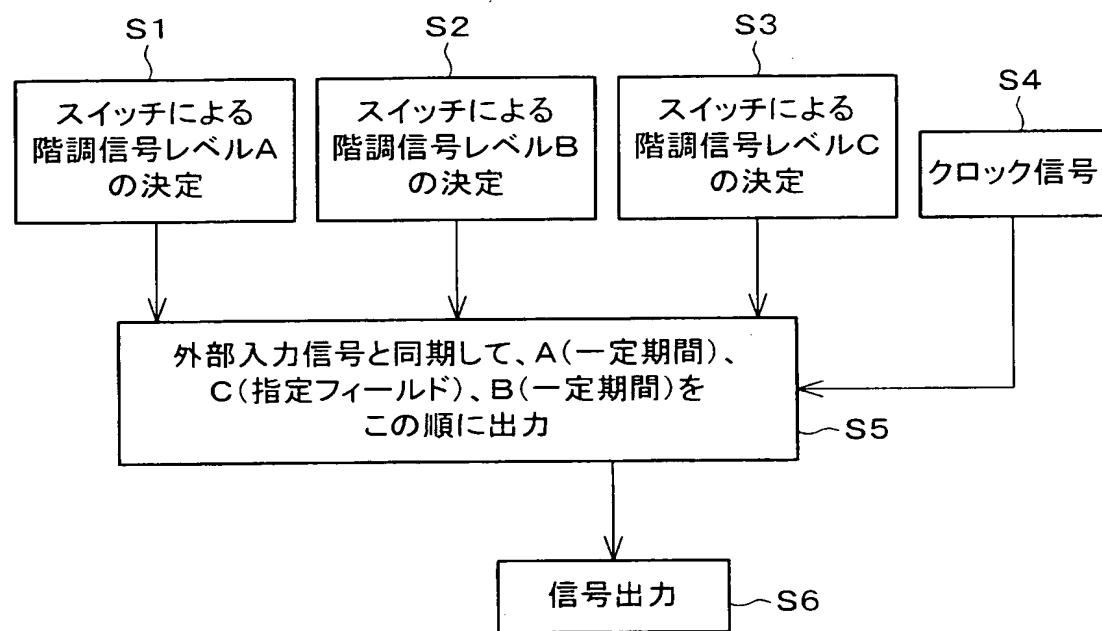
評価装置1



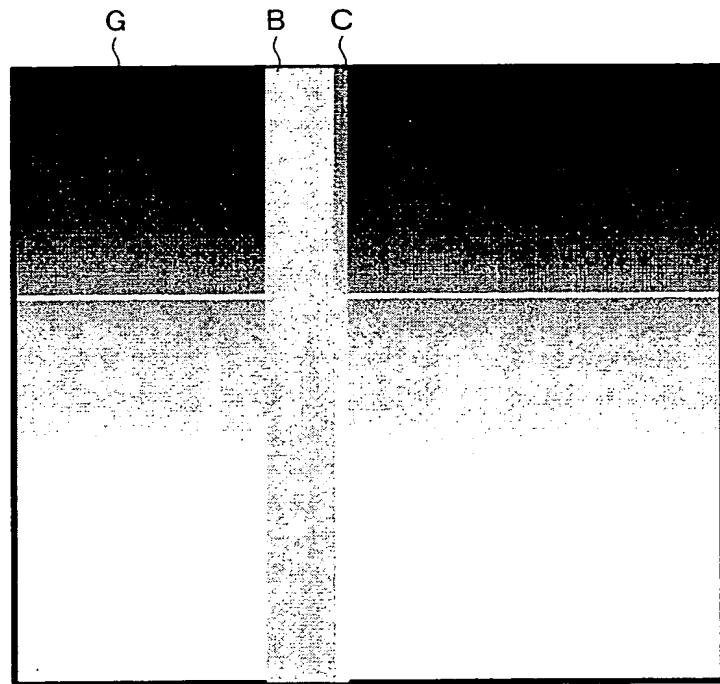
【図2】



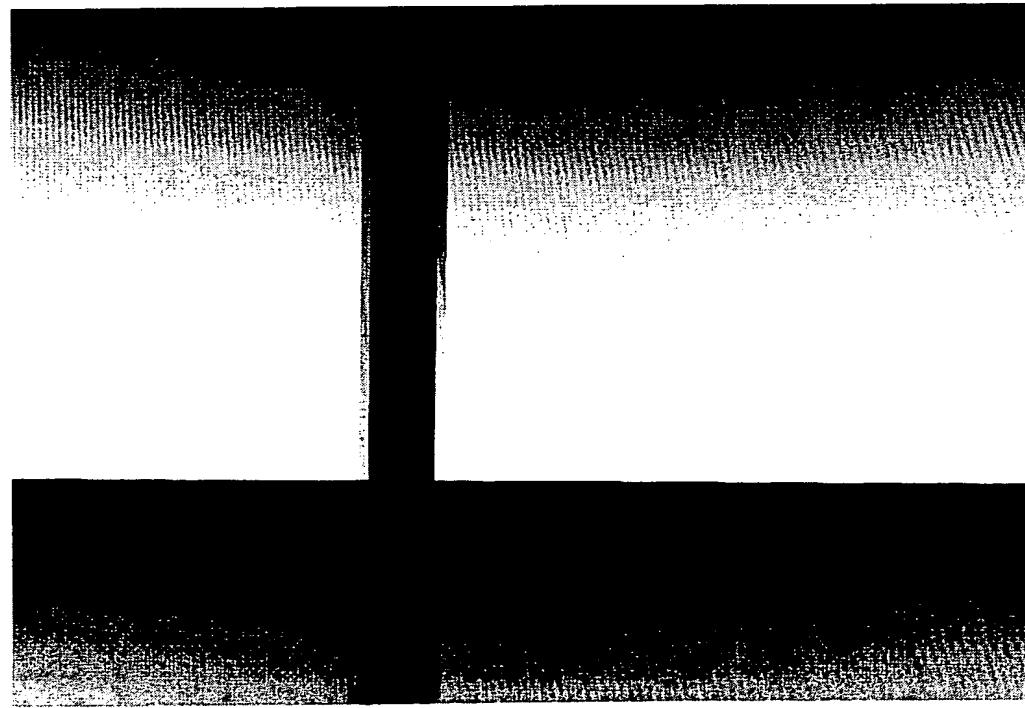
【図3】



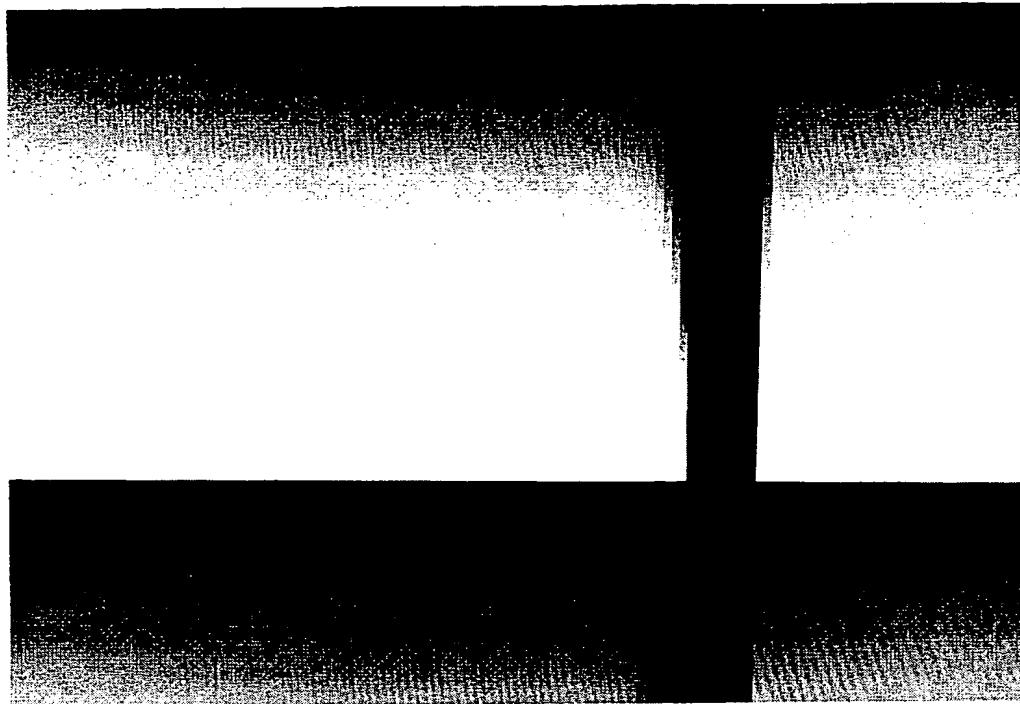
【図4】



【図5】

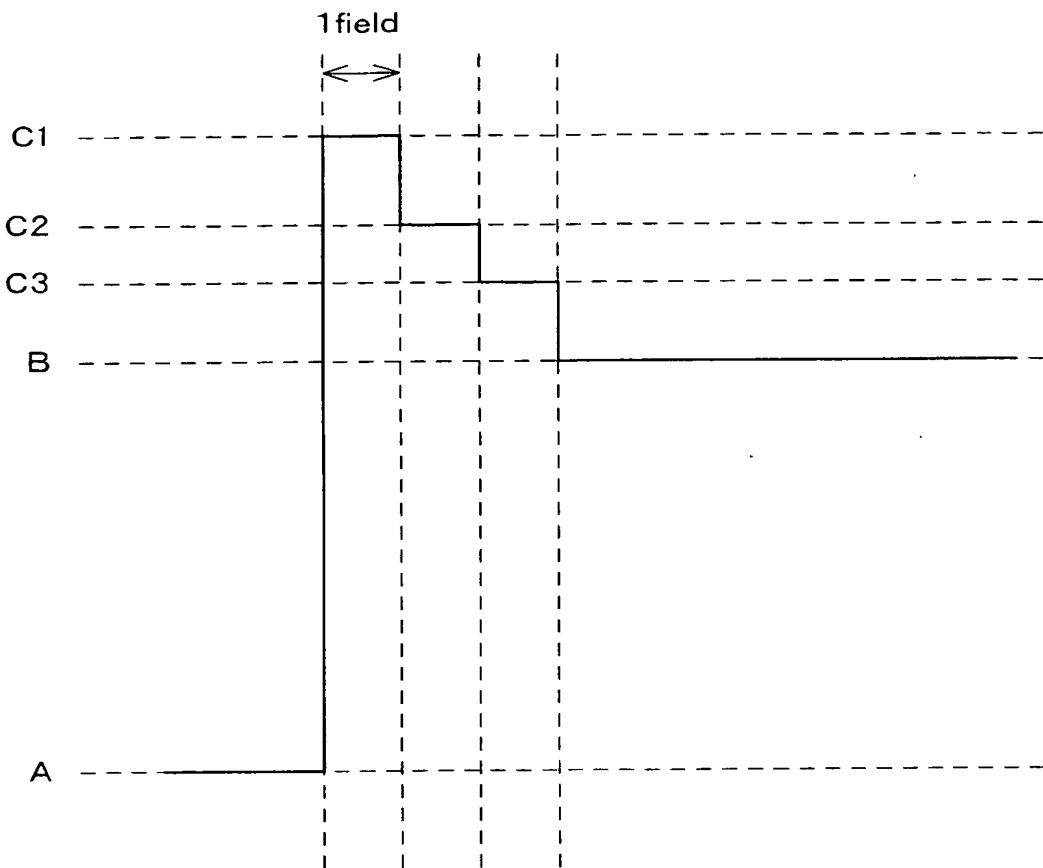


【図6】

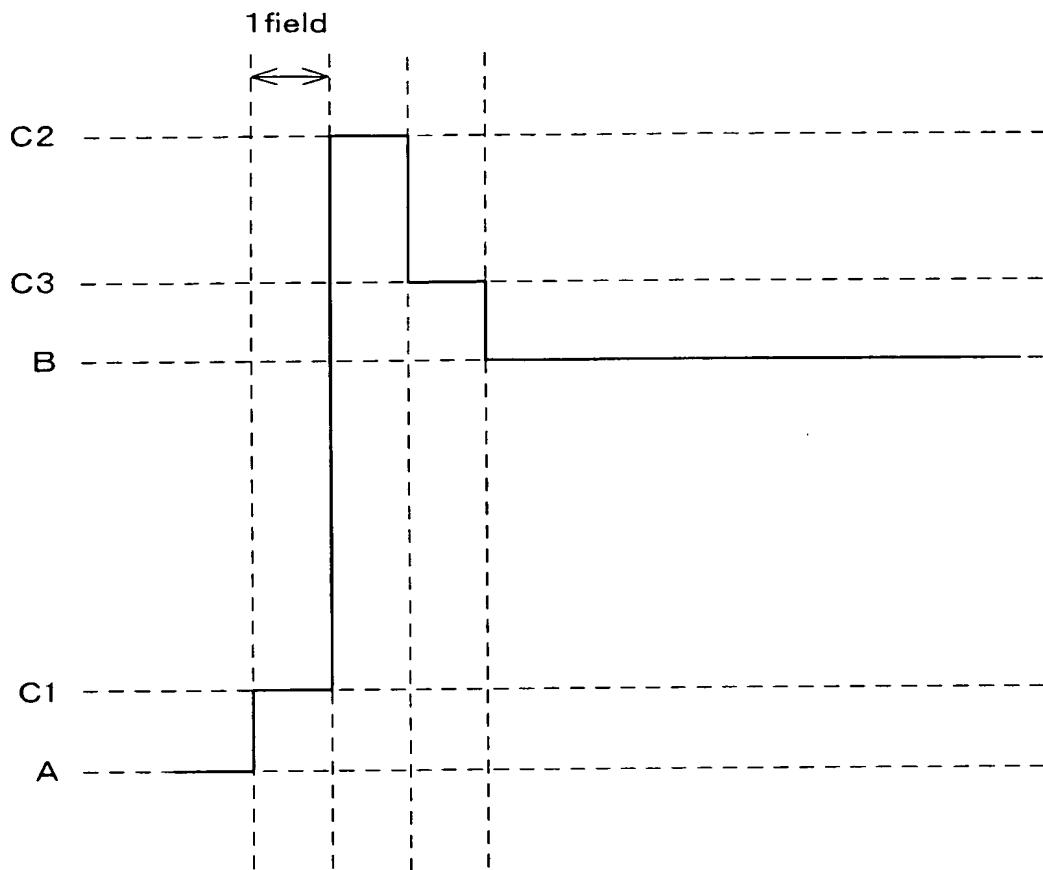


出証特2004-3023356

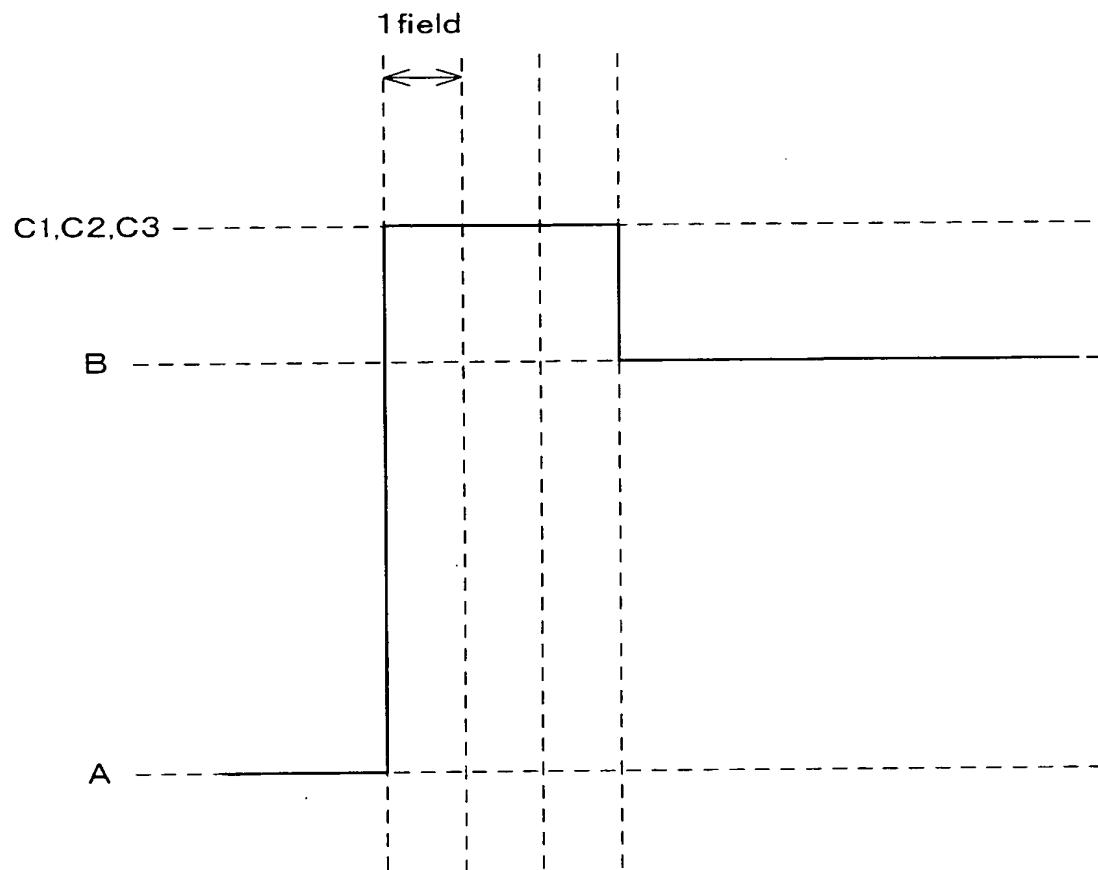
【図7】



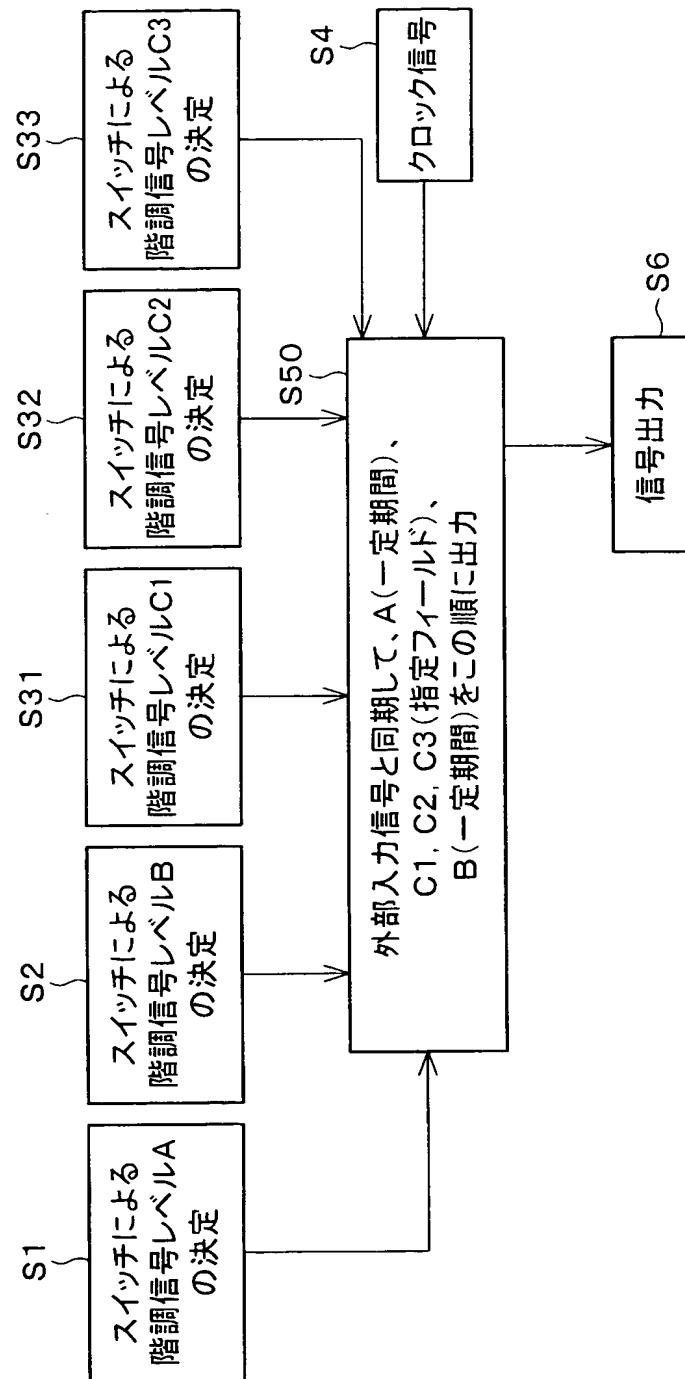
【図8】



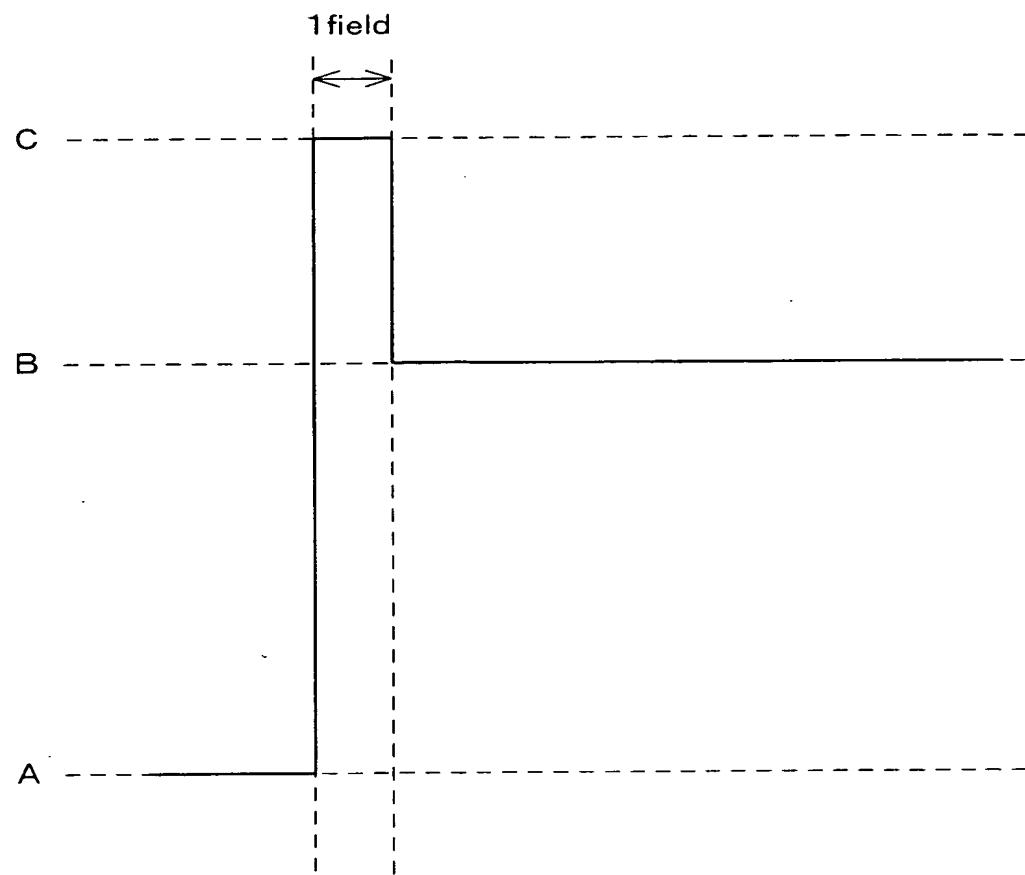
【図9】



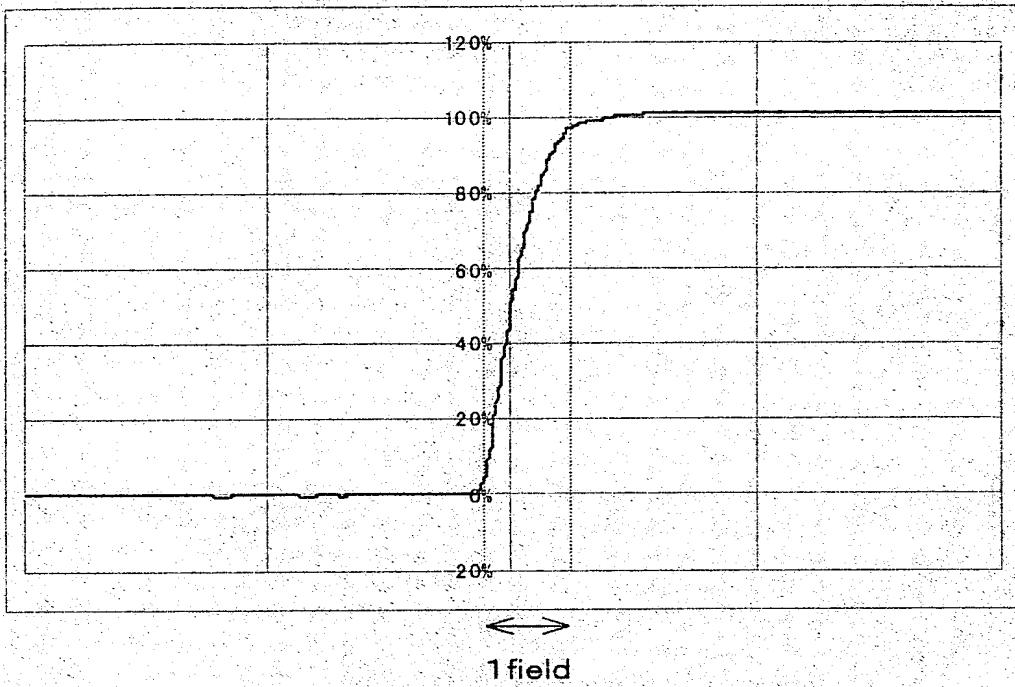
【図10】



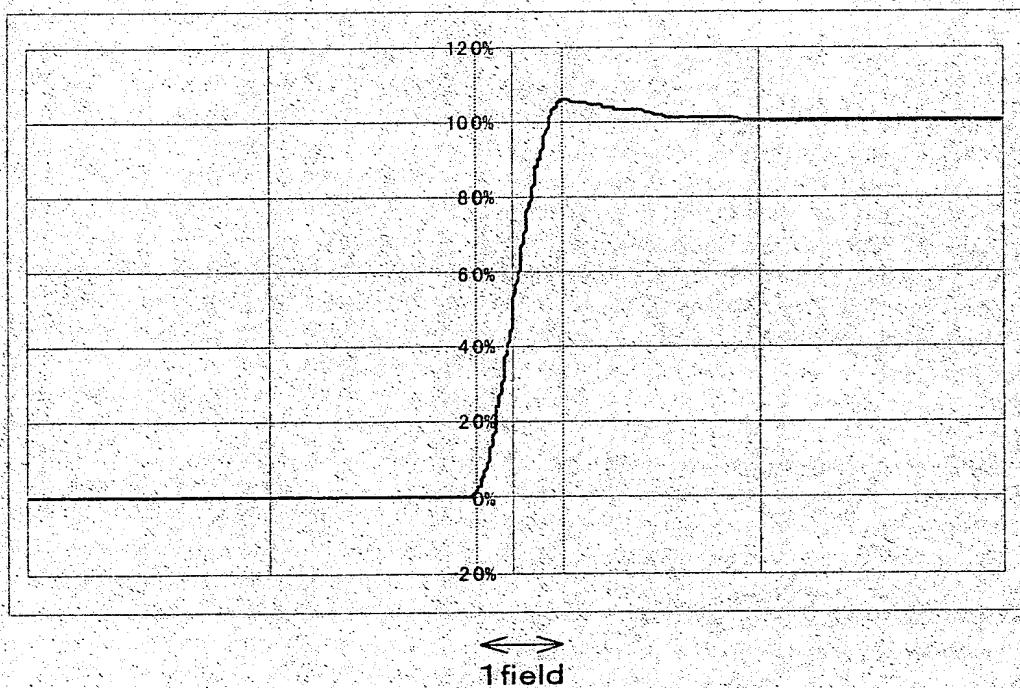
【図 1 1】



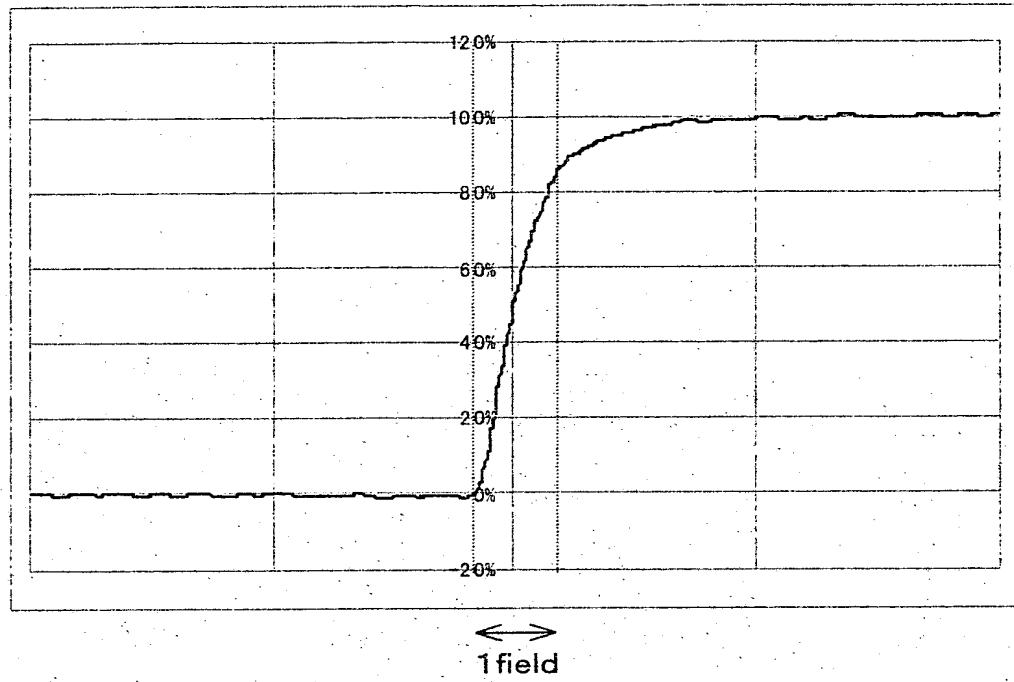
【図12】



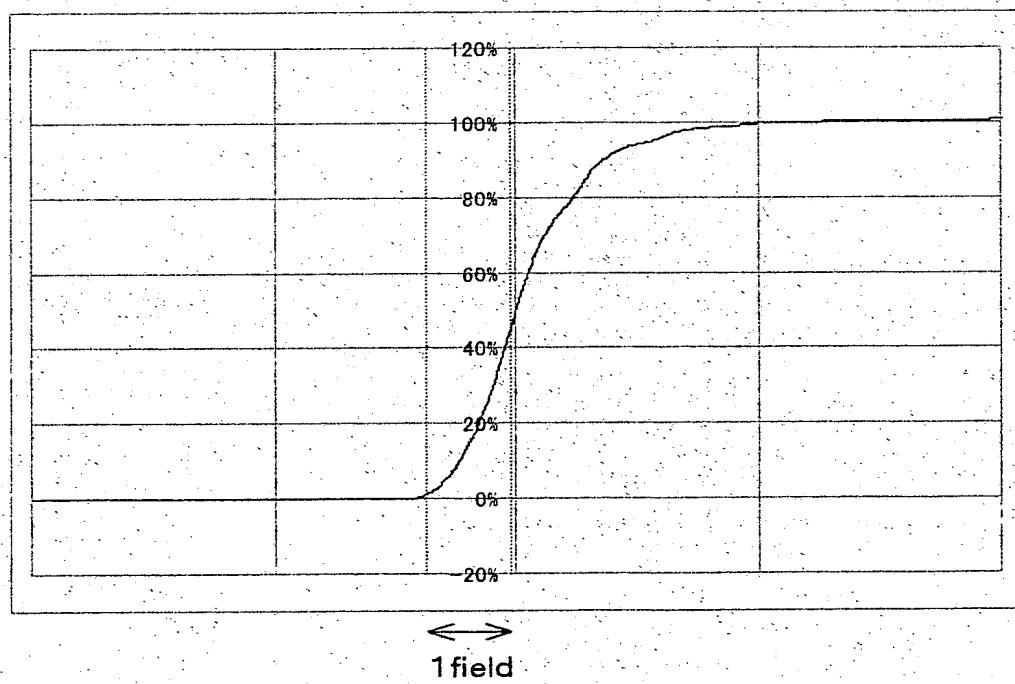
【図13】



【図14】



【図15】



【書類名】 * 要約書

【要約】

【課題】 液晶パネル2の最適なオーバーシュートパラメータを、容易、かつ高精度に求められるようにする。

【解決手段】 先ず、階調を変化させる前の任意の階調をAとし、到達させるべき任意の階調をBとし、オーバーシュート信号のレベルをCとするとき、Cを掃引させつつ、A→C→Bの順でレベルが変化する映像信号を順次出力する映像信号発生回路3を設ける。次に、それぞれの映像信号による液晶パネル2の表示画像を光学受光素子4で光電変換し、前記波形解析装置5に取込む。続いて、波形解析装置5は、掃引された種々のCによる液晶パネル2の表示結果の中で、過剰応答がなく、到達階調Bに最も速く到達したレベルを、前記最適オーバーシュートパラメータとして、変化前の階調Aおよび到達階調Bに対応付けてストアしてゆき、オーバーシュート駆動用のルックアップテーブルを作成する。

【選択図】 図1

特願 2003-032893

出願人履歴情報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住所 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
氏名 シャープ株式会社